รหัสโครงการ SUT7-711-58-12-12



รายงานการวิจัย

การสร้างชั้นรอยต่อพาสซิเวชันคุณภาพสูงของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย เทคนิคต้นทุนต่ำจากการประทับลาย Fabrication of high quality passivated contacts in Solar cells by using a low-cost stamp technique



ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

รหัสโครงการ SUT7-711-58-12-12



รายงานการวิจัย

การสร้างชั้นรอยต่อพาสซิเวชันคุณภาพสูงของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย เทคนิคต้นทุนต่ำจากการประทับลาย Fabrication of high quality passivated contacts in Solar cells

by using a low-cost stamp technique

ผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2558 ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

สิงหาคม 2561

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี งบประมาณ 2558 ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผศ.ดร. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์

2561



บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบของเครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติ (Quasiautomatic stamp machine) การสร้างลวดลายของฟิล์มบางไดอิเล็กทริก และฟิล์มสารเจือ บนแผ่น ซิลิคอนรอยต่อพี-เอ็น เพื่อปรับปรุงโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยไม่พึ่งพาเทคนิค สร้างลวดลายแบบโฟโตลิโทรกราฟี ที่มีขั้นตอนความซับซ้อน เครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติสามารถสร้าง ลวดลายฟิล์มบางได้ในขั้นตอนเดียว ประหยัดวัสดุ สามารถสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ำได้ ส่วนประกอบเครื่องต้นแบบประกอบด้วย ชุดแผ่นประทับลายผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์ไวแสงแฟลช (Flash foam) มีโครงสร้างรูพรุน ดูดซับสารละลายได้ดี ชุดส่งกำลังโดยใช้บอลสกรู และเพืองขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์แบบสเต็ป ที่ควบคุมความเร็วรอบและทิศทางการหมุนได้ ด้วยการควบคุมการทำงานจากคำสั่ง โปรแกรมที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิดอาดูโน Arduino) วัตถุประสงค์ของการออกแบบเครื่อง ประทับลายกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ เพื่อสามารถใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชิลิคอนโครงสร้างที่ให้ประสิทธิภาพสูง ที่มีขนาดต่าง ๆ ได้ เช่น 3 cm², 4 cm², 5.5 cm² และ 8 cm² โดยขนาดของลายเส้นเล็กสุดได้ 100 ไมครอน ผลการทดสอบพบว่าเครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติ ให้ลวดลายฟิล์มบางลงบนแผ่นเซลล์ แสงอาทิตย์ที่แม่นยำ ได้ขนาดของลายเส้นที่มีความสม่ำเสมอได้ตามที่ต้องการ ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่ เกิน 2.5% เมื่อเทียบกับลายต้นแบบ

เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนรอยต่อ n/p โครงสร้างชั้นสนามไฟฟ้าด้านหลังบางบริเวณ (Local back surface field, LBSF) ได้ทดสอบผลิตด้วยเครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติ โดยทำการประทับลายของโบรอน ซึ่งเป็นแหล่งสารเจือสำหรับการสร้างบริเวณ p⁺⁺ ด้านหลังเซลล์ และขั้นตอนการประทับลายของกรดไฮโดร ฟลูออริก สำหรับสกัดเปิดช่องให้กับชั้นไดอิเล็กทริกที่บริเวณเดียวกันกับ p⁺⁺ ซึ่งขนาดลวดลายดังกล่าวมีผล ต่อการเพิ่มขึ้นของค่าประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมาก โดยเซลล์ที่มีขนาดลายเส้น 500 µm ที่ Aperture ratio 15% ให้ค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 1.46% เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่เปิดช่อง ดังนั้นเซลล์ แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ด้วยวิธีประทับลาย สามารถนำไปผลิตในปริมาณมากในอุตสาหกรรมเซลล์ แสงอาทิตย์ได้ เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ขั้นตอนการผลิตเซลล์ไม่ซับซ้อนสอดคล้องกับการผลิตเดิมที่มีอยู่

Abstract

This research involves with design and fabrication of a prototype quasi-automatic machine for producing the film patterns based on stamping technique. The patterned dielectric film and doping film were created on n/p junction silicon wafer in order to improve the higher efficiency of silicon solar cells without using a complex photolithography technique. The guasi-automatic stamp machine can produce the patterned film in one procedure step, conserve the raw solution material and use for producing low-cost solar cells. The stamp machine consists of the many main components such as flash foam part which is a good adsorb porous-polymer. Power transmission part by using a ball screw system and gear driver with stepping motor to be controllable its speed and its directional rotation. The stamper distance to solar cell is controlled by programing Arduino microcontroller. This design contributes solar cell production with various sizes such as cells 3 cm², 4 cm², 5.5 cm² และ 8 c<mark>m².</mark> Flash foam is a polymer material which has flash light responsibility. The line pattern was obtained the smallest size of 100 micro-meters. The experimental results are found that the machine obtained accurately the line pattern on the solar cell wafers. The desired width of line is patterned straightly with its error below 2.5% comparing with the original-pattern.

Prototype of crystalline n/p Si solar cells based local back surface field (LBSF) were demonstrated by using a quasi-automatic stamp machine. Formation of p⁺⁺ pattern from stamping boron dopant solution was tested on the rear side of n/p-Si substrate. In additional study, patterning hydrofluoric acid stamps on dielectric layer to form the line opening which is positioned to the p⁺⁺ line. The line width of localized p⁺⁺ region directly effects to solar cell efficiency. 500 micrometers width with 15% aperture ratio can contribute the power conversion efficiency improvement by 1.46% comparing to a solar cell with fully dielectric rare-layer. Therefore, LBSF solar cells based stamping technique lead to mass-production in PV industrial process owing to low-cost and simple techniques.

สารบัญ

			หน้า
กิตติกรร	มประก	าศ	ก
บทคัดย่ะ	9		ๆ
Abstrac	:t		ዋ
สารบัญ			٩
สารบัญต	การาง		ຉ
สารบัญม	าาพ		V
บทที่ 1	บทน'	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
	1.1	ความเป็นมาและความสำคัญข <mark>องปัญหา</mark>	1
	1.2	วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	6
	1.3	ขอบเขตของงานวิจัย	6
	1.4	วิธีดำเนินการวิจัย	7
	1.5	ประโยชน์ที่ได้รับจาก <mark>งาน</mark> วิจัย	7
บทที่ 2	ทฤษมู่	ู่ วีการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แ <mark>สงอาทิตย์</mark>	
	2.1	บทนำ	9
	2.2	การออกแบบ <mark>เครื่องป</mark> ระทับลายกึ่งอัตโนมัติ	9
	2.3	การเลือกขนาดข <mark>องสเต็ปมอเตอร์และการออกแบบวงจ</mark> รไฟฟ้า	15
		2.3.1 การคำนวณหาขนาดของสเต็ปมอเตอร์	15
		2.3.2 การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง	16
		2.3.3 วงจรควบคุมสเต็ปมอเตอร์	17
	2.4	สรุป	18
บทที่ 3	การท	ดสอบประทับลวดลายสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์	
	3.1	บทนำ	19
	3.2	ลักษณะพื้นผิวของแผ่น Flash foam	19
		3.2.1 การสร้างลวดลายสารไวแสงด้วย Foam stamp	20
		3.2.2 การสร้างลวดลาย Borosilicate ด้วย Foam stamp	22
		3.2.3 การเปิดช่องไดอิเล็กทริกด้วย Foam stamp	26

สารบัญ (ต่อ)

			หน้า
	3.3	สรุป	27
บทที่ 4	เซลล์เ	เสงอาทิตย์ซิลิคอนต้นแบบด้วยวิธีการประทับลาย	
	4.1	บทน้ำ	28
	4.2	กระบวนการผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกซิลิคอนเชิงพาณิชย์	28
	4.3	เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนต้นแบบ LBSF ด้วยวิธีการประทับลาย	32
		4.3.1 การผลิตเซลล์ที่มีบริเวณ <mark>p+</mark> + Si ในแบบลวดลายเส้น และลายจุด	
		ด้วยวิธีการประทับลาย	32
		4.3.2 การวัดคุณสมบัติทางแ <mark>สงและว</mark> ัดค่า life-time	33
		4.3.3 ผลการวัดค่าดัชนีหักเ <mark>ห</mark> แสงแล <mark>ะ</mark> ความหนาของฟิล์มไดอิเล็กทริกบน	
		เซลล์	35
	4.4	เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอ <mark>นต้นแบบด้วยการ<mark>ประ</mark>ทับลาย</mark>	38
	4.5	การวิเคราะห์ต้นทุนต่ <mark>อหน่</mark> วย และความคุ้มค่า <mark></mark>	43
	4.6	สรุป	47
บทที่ 5	สรุปผ	ลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ	
	, 5.1	สรุปผลงานวิจัย	48
		5.1.1 การออ <mark>กแบบและสร้างเครื่องประทับลายกึ่งอั</mark> ตโนมัติสำหรับเซลล์	
		แสงอาทิตย์	48
		5.1.2 การถ่ายทอดลวดลายด้วย Foam stamp	48
		5.1.3 การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนต้นแบบด้วยวิธีการประทับลาย	48
		5.1.4 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนโครง	
		สร้าง LBSF ต้นแบบด้วยวิธีการประทับลาย	49
	5.2	ข้อเสนอแนะ	49
บรรณานุเ	ารม		50
ประวัติผู้วิ	จัย		53

สารบัญตาราง

ฉ

ตารางที่ 2.1	ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องประทับลาย	10
ตารางที่ 3.1	ผลการประทับลาย BSG แบบลายเส้นและลายจุดเปรียบเทียบกับลวดลาย	
	ที่ออกแบบในเงื่อนไขขนาดลวดลาย	24
ตารางที่ 3.2	ผลการประทับลาย BSG แบบลายเส้นเปรียบเทียบกับลวดลายที่ออกแบบ	
	ในเงื่อนไข Aperture ratio	25
ตารางที่ 4.1	นิยามของเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบใ <mark>นโ</mark> ครงสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ	33
ตารางที่ 4.2	ค่าความหนาและค่าดัชนีหักเหแส <mark>งขอ</mark> งชั้ <mark>น</mark> ฟิล์มบางไดอิเล็กทริก	35
ตารางที่ 4.3	ค่าช่วงชีวิตของพาหะ และค่าอัต <mark>ราความเ</mark> ร็วในการรวมตัวใหม่ของพาหะ	
	ค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดัน	36
ตารางที่ 4.4	ค่าทางไฟฟ้าและประสิทธิภา <mark>พการแปลงพลังง</mark> านของเซลล์แสงอาทิตย์โครง	
	สร้าง LBSF	41
ตารางที่ 4.5	ส่วนประกอบของต้นทุ <mark>นกา</mark> รผลิตแผ่นเซลล์แสง <mark>อาทิ</mark> ตย์ในเชิงพาณิชย์	44
ตารางที่ 4.6	การเปรียบเทียบต้นทุ <mark>นกา</mark> รผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ผลึก <mark>โ</mark> พลีซิลิคอนโครงสร้าง	
	มาตรฐานอุสาหก <mark>รร</mark> มใน <mark>ประเทศไทย กับการคาดก</mark> าร <mark>ณ์ต้</mark> นทุนการผลิตเซลล์	
	ในงานวิจัย	46
ตารางที่ 4.7	สรุปต้นทุนการ <mark>ผลิตแผ่นเซลล์ในโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาด</mark> โลก	47
	รัฐว _ั กยาลัยเทคโนโลยีสุรับโร	

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	
รูปที่ 1.1	กฎของ Liebig สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน
รูปที่ 1.2	ผลการคำนวณประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนในฟังก์ชันของพารา
	มิเตอร์ความเร็วของการรวมตัวใหม่
รูปที่ 1.3	โครงสร้างของการทำพาซิเวชันที่ผิวในแบบแผนพื้นฐานต่าง ๆ กัน (ก) BSF เต็มพื้น
	ที่ด้านหลัง (ข) SiN _x -passivated bifa <mark>cia</mark> l cell (ค) Oxide-passivated point
	contact (ง) Oxide-passivated poi <mark>nt</mark> contact กับ LBSF
รูปที่ 1.4	เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงชนิด <mark>ชิลิค</mark> อนในโครงสร้างแบบ PERL
	(Passivated Emitter, Rear Locally-diffusion cells)
รูปที่ 1.5	บริเวณการตอบสนองแสงคลื่นสั้นแ <mark>ล</mark> ะคลื่น <mark>ย</mark> าวของเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง
	Selective emitter
รูปที่ 2.1	ส่วนประกอบของเครื่องประทับลายต้นแบบ
รูปที่ 2.2	เครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติ
รูปที่ 2.3	ชุดหัวบรรจุแผ่น Flash foam
รูปที่ 2.4	แผ่น POM สำหรับฐานวางแผ่นซิลิคอน
รูปที่ 2.5	แผ่นอะคริลิคสำหรับรองแผ่น POM และต่อร่วมกับท่อดูดสุญญากาศ
รูปที่ 2.6	เครื่องประทับลา <mark>ย ชุดควบคุมสต์ปมอเตอร์ และเครื่องดูดสุญ</mark> ญากาศ
รูปที่ 2.7	วงจรไฟฟ้าของแหล่งจ่ <mark>ายไฟฟ้า ขนาด</mark> 24∨ 3A
รูปที่ 2.8	การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ควบคุ <mark>มสเต็ปมอเตอร์</mark>
รูปที่ 3.1	(ก) โครงสร้างพื้นผิวของ Flash foam ที่กำลังขยาย 300 เท่า และ (ข) ที่กำลัง
-	ขยาย 2000 เท่า
รูปที่ 3.2	ภาพถ่าย (ก) เครื่อง Flash Stamp รุ่น JL-V และ (ข) หลอดแฟลชภายในเครื่อง
รูปที่ 3.3	ลวดลายหน้ากากปิดแสงลักษณะแบบขั้วไฟฟ้ากริด
ร รูปที่ 3.4	(ก) ลักษณะของลวดลายที่เกิดขึ้นบน Foam stamp และ (ข) ภาพขยายกำลัง
0	ขยาย 50 เท่า
รูปที่ 3.5	ลวดลายสารไวแสงที่เกิดขึ้นหลังจากการประทับลาย และ (ข) ภาพขยายที่
υ	กำลังขยาย 50 เท่า
รูปที่ 3.6	(ก) ลวดลายหลังจากผ่านการ Etching back และ (ข) ภาพถ่ายลักษณะ
J	ลวดลายหลังจากผ่านการEtching back ที่กำลังขยาย 50 เท่า

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่

รูปที่ 3.7	โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ LBSF	23
รูปที่ 3.8	ลวดลายฟิล์ม BSG บนแผ่นฐาน p-Si ด้วยการประทับลาย (ก) ลวดลายขนาด	
	100 µm (ข) ขนาด 250 µm และ (ค) ขนาด 500 µm และลวดลายแบบจุด	
	ขนาด (ง) 250 µm (จ) 500 µm และ (ฉ) 1000 µm	23
รูปที่ 3.9	ลวดลาย BSG บนแผ่นฐาน p-SI ด้วยการประทับลายมีขนาด 250 µm และ	
	Aperture ratio ที่ (ก) 20% (ข) 15 <mark>% (</mark> ค) 10% และ (ง) 5%	25
รูปที่ 3.10	ลวดลายการเปิดช่องชั้นฟิล์ม SiN _x ด้วย <mark>กา</mark> รประทับลายแบบที่ขนาด 250 µm	
	ในเงื่อนไขAperture ratio ที่ (ก) 2 <mark>0% (ข)</mark> 15% (ค) 10% และ (ง) 5%	26
รูปที่ 4.1	การสกัดผิวผลึกซิลิคอนด้วยสารละ <mark>ล</mark> ายเคม <mark>ี</mark> และผิวขรุขระกับการลดลงของแสง	
	สะท้อน	28
รูปที่ 4.2	การแพร่สารเจือในเตาอุณหภูมิสูง	29
รูปที่ 4.3	การสกัดผิวที่ขอบแผ่นเพื่ <mark>อก</mark> ำจัดบริเวณที่ฟอสฟอ <mark>รัสแ</mark> พร่ซึม	29
รูปที่ 4.4	การสร้างชั้น SiNx ในร <mark>ะ</mark> บบเตา PECVD	29
รูปที่ 4.5	การพิมพ์ลายขั้วไฟฟ้า	30
รูปที่ 4.6	กระบวนการ Fa <mark>st fi</mark> ring ให้กับโลหะขั้วไฟฟ้า	30
รูปที่ 4.7	กระบวนการทด <mark>สอบและ</mark> คัดเลือกเซลล์ตามค่าประสิทธิ <mark>ภาพ.</mark>	30
รูปที่ 4.8	เปรียบเทียบกระบวน <mark>การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง</mark> LBSF ต้นทุนต่ำ	
	ด้วยวิธีประทับลาย (Stamping) <mark>กับกระบวนการผลิตเ</mark> ซลล์เชิงพาณิชย์	30
รูปที่ 4.9	ภาพตัดขวางของโครงสร้างเซลล์ที่มีบริเวณ p ⁺⁺ Si ในแบบลวดลายเส้น	32
รูปที่ 4.10	Ellipsometer รุ่น SE 400advanced สำหรับวัดความหนาและค่าดัชนี	
	หักเหแสงของชั้นฟิล์มบางไดอิเล็กทริก	34
รูปที่ 4.11	เครื่องวัดค่าช่วงชีวิตของพาหะ Sinton รุ่น WCT-120 จากศูนย์เทคโนโลยี	
	อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)	34
รูปที่ 4.12	กราฟความสัมพันธ์ของค่าช่วงชีวิตของพาหะ และอัตราความเร็วในการรวม	
	ตัวใหม่ของพาหะของเซลล์ทดสอบต่าง ๆ	37
รูปที่ 4.13	กราฟความสัมพันธ์ของค่ากรแสมืด และแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรที่ได้จากการ	
	วัด Life time	37
รูปที่ 4.14	โครงสร้าง Local back passivation ที่ทำการศึกษา	38

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่		
		หน้า
รูปที่ 4.15	ลวดลายการเปิดช่องชั้นฟิล์ม SiN _x ด้านหลังแผ่นเซลล์ ด้วยเทคนิคการ	
	ประทับลายที่มี Aperture ratio ประมาณ15% และขนาดลายเส้นเปิด	
	เท่ากับ (ก) 100 µm (ข) 250 µm และ (ค) 500 µm	39
รูปที่ 4.16	เครื่อง Fast firing ที่สร้างขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ F5105	40
รูปที่ 4.17	(ก) ภาพถ่ายด้านบนของเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบ และ (ข) ด้านหลังเซลล์	40
รูปที่ 4.18	กราฟ J-V ของเซลล์แสงอาทิตย์ LBS <mark>F ใ</mark> นลายเส้นเปิดช่อง SiN _x	42
รูปที่ 4.19	กราฟ J-V ของเซลล์แสงอาทิตย์ LBS <mark>F ใน</mark> ลายจุดเปิดช่อง SiN _x	42



บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

้จากการที่ประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความจำเป็นที่ต้องเตรียม หาแหล่งพลังงานสำรองในอนาคต เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า การ พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะเป็นหนทางที่ช่วยลดการพึ่งพาและการนำเข้าพลังงานได้ พลังงาน ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนอย่างหนึ่งซึ่งสามารถนำมาทดแทนก๊าซธรรมชาติสำหรับ การผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ไม่จำเป็นต้<mark>อง</mark>มีต้นทุนการจัดหาพลังงาน เป็นแหล่งพลังงานที่เป็น ้มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์อ<mark>ิเล</mark>็กทรอนิกส์ที่สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ้ปราศจากกลไกทางกล และไม่ปล่อยก๊าซเรือนกร<mark>ะจุกใด</mark> ๆ ระหว่างการแปลงพลังงาน ในปัจจุบันได้มีการ ้สนับสนุนในเชิงนโยบายการผลิตไฟฟ้าด้วยเซล<mark>ล์</mark>แสงอ<mark>า</mark>ทิตย์ในรูปธรรมมากขึ้น จากการเริ่มนโยบายการ ้สนับสนุนการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แส<mark>ง</mark>อาทิตย์ในระดับ VSPP (Very small power producer) ู้ในปี พ.ศ. 2551 พร้อมกับมีเพิ่มราคารับซื้<mark>อไฟ</mark>ฟ้า (Adder) ทำให้เกิดการขยายตัวในการติดตั้งเพื่อขาย ้ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งขนาดกำลังผลิตเข้าใก<mark>ล้ระ</mark>ดับกำลังไฟฟ้าเป<mark>้าหม</mark>ายตามนโยบายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและ<mark>งาน</mark>วิจัยที่เกี่ยว[ู]ข้องกับวั<mark>สดุส</mark>ำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็น การสนับสนุนกระบวนการต้นน้ำนั้นยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่า ดังนั้นการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและงานวิจัย ้ที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดองค์คว<mark>าม</mark>รู้แ<mark>ละมุ่งไปสู่การผลิตและป</mark>ฏิบัติไ<mark>ด้นั</mark>้นจะสามารถทำให้ประเทศไทยมี ศักยภาพด้านพลังงานทดแท<mark>นทั้ง</mark>การใช้งานซึ่งเป็นกระบวนการปลายน้ำจนไปถึงด้านองค์ความรู้ทาง เทคโนโลยีและการผลิตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นกระบวนการต้นน้ำ สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนสร้างความมั่นคงอย่าง ้ยั่งยืนด้านพลังงานของชาติได้ในอ<mark>นาคต</mark> 10

จากผลงานด้านวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์นั้น เราพบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพสูงชนิดผลึกซิลิคอนในโครงสร้างแบบ PERL (Passivated Emitter, Rear Locally-diffusion cells) ที่ห้องปฏิบัติการเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ UNSW ได้พัฒนาให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดประมาณ 25±5% อย่างไรก็ตามเราพบว่ากระบวนการผลิตมีความซับซ้อนจากการผลิตชั้นพาสซิเวชันแบบเปิดช่องรอยสัมผัส ด้วยเทคนิค Photolithography จึงทำให้โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์นี้ที่ให้ประสิทธิภาพการแปลง พลังงานสูงสุดไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม นอกจากนั้นต้นทุนการผลิตที่สูง เนื่องจากการผลิตลายโลหะมีกระบวนการที่ใช้ระบบสุญญากาศพิเศษด้วยเทคนิค Thermal evaporation ชั้นพาสซิเวชันคือชั้นฉนวนไดอิเล็กทริกบาง ๆ เช่น SiO₂ และ SiN_x ที่อยู่ระหว่างชั้นสารกึ่งตัวนำซิลิคอนกับ ขั้วไฟฟ้าซึ่งมีโครงสร้างแบบ MIS (Metal-Insulator-Semiconductor) ทำให้เกิดการสะสมของประจุ ต่างกันเกิดเป็นสนามไฟฟ้าอ่อน ๆ ผลของสนามไฟฟ้าที่บริเวณผิวสัมผัสของ MIS นี้จะส่งผลให้ความเร็วใน การรวมตัวใหม่ของพาหะมีค่าลดลง หรืออีกนัยหนึ่งคือช่วงชีวิตของพาหะยาวขึ้น และเกิด V_{oc} มีค่าสูงขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์สูงขึ้น รูปที่ 1 แสดงการนำกฎของ Liebig มาปรับใช้กับ เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยของการสูญเสียพลังงานในเซลล์ เราพบว่าการสูญเสียมากที่สุดนั้น เนื่องจากเกิดความเร็วของการรวมตัวใหม่สูงที่บริเวณผิวโดยเฉพาะที่ด้านหลังของเซลล์ (Rear surface recombination)



รูปที่ 1.1 กฎของ Liebig สำ<mark>หรับเซ</mark>ลล์แสงอาทิ<mark>ตย์ชนิด</mark>ซิลิคอน [S.W.Glunz, 2007]

เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์จำเป็นต้องลดความเร็วของการรวมตัวใหม่ของพาหะข้าง น้อย (Minority carriers) ที่ผิวนั้นทำได้โดยหลักการของพาสซิเวชันที่ผิว (Surface passivation) ให้มี ประสิทธิภาพสูง ถึงแม้ว่าการทำพาสซิเวชันที่ผิวจะสามารถให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงเข้าใกล้ ค่าจำกัดสูงสุดของเซลล์ชนิดซิลิคอนก็ตาม แต่กระบวนการผลิตก็ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของ Photolithography และเลเซอร์ ซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อนและยุ่งยาก โดยฉพาะอย่างยิ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูง มาก แม้ว่าจุดประสงค์หลักของการใช้ Photolithography นั้นไม่ได้มุ่งไปสู่การทำลวดลายที่มีขนาดเล็กก็ ตาม

โดยทั่วไปเป็นที่ยอมรับกันว่าจุดหลักสำคัญอย่างหนึ่งของการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนให้ ได้ประสิทธิภาพสูงคือการทำให้ผิวทั้งด้านบน และด้านหลังของเซลล์เกิดพาสซิเวชัน (Passivation) คุณภาพสูง เพื่อลดความเร็วของการรวมตัวใหม่ของพาหะข้างน้อยเป็นผลให้ V_{oc} มีค่าสูงขึ้นส่งผลให้ ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเซลล์ยิ่งมีความบางลงมากเท่าใด ค่า ความเร็วของการรวมตัวใหม่นี้ก็จะมีผลกระทบมากขึ้นด้วยแสดงความสัมพันธ์ด้วยผลการคำนวณดังรูปที่ 2 สำหรับการลดค่าความเร็วของการรวมตัวใหม่นั้นมีหลายวิธี อาทิเช่น วิธีแรกคือการลดความหนาแน่นของ สถานะที่ผิวสัมผัส (Density of interface states, Dit) วิธีที่สองคือการทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นเพื่อผลัก พาหะข้างน้อยออกไปไม่ให้เกิดการรวมตัวที่บริเวณผิวเสียก่อน วิธีการพื้นฐานเหล่านี้เรียกโดยรวมว่าการทำ พาซิเวชันที่ผิว (Surface passivation)



ร**ูปที่ 1.2** ผลการคำนวณประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนในฟังก์ชันของพารามิเตอร์ ความเร็วของการรวมตัวใหม่ [Metz A., et.al. 2000]

วิธีการต่าง ๆ ในการทำพาซิเวชันที่ผิวนั้นมีแบบแผนพื้นฐานต่าง ๆ กันแสดงดังรูปที่ 3 ดังนี้ 1. การ สร้างชั้น P+ บางๆ เพื่อให้เกิดสนามไฟฟ้าที่ด้านหลังทั้งหมดของเซลล์ (Back surface field, BSF) [A. Mandelkorn , et.al. 1973] แสดงในรูป (ก) 2. การสร้างชั้นฟิล์มบาง SiN_x ในโครงสร้างของเซลล์ แสงอาทิตย์แบบสองหน้า [R. Hezel et.al. 1989] แสดงในรูป (ข) 3. การสร้างชั้นออกไซด์แบบจุดสัมผัส (Oxide-passivated point contact) หรือเรียกว่า Local back passivation (LBSF) ในรูป (ค) และแบบ LBSF ที่มีการแพร่ p⁺⁺ [J. Zhao, et. al. (1990)] แสดงในรูป (ง)



รูปที่ 1.3 โครงสร้างของการทำพาซิเวชันที่ผิวในแบบแผนพื้นฐานต่าง ๆ กัน (ก) BSF เต็มพื้นที่ด้านหลัง (ข) SiNx-passivated bifacial cell (ค) Oxide-passivated point contact (ง) Oxidepassivated point contact กับ LBSF

ปัจจุบันนี้แบบแผนพื้นฐานของการทำพาซิเวชันที่ผิวได้มีการนำมาพัฒนาในรูปแบบหลักการที่ แตกต่างกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการการแปลงพลังงานดีขึ้น เช่นหลักการของเซลล์ซิลิคอนแบบ IBBC (Interdigitated back-side buried contact) ที่ UNSW ได้ประสิทธิภาพสูงถึง 19.2% [J-H. Guo, et. al., 2005] และบริษัท Sunpower ได้พัฒนาหลักการแบบ BC-BS (Back-contact back-side) ได้ ประสิทธิภาพกว่า 22% [D. De Ceuster, et. al. 2007] และงานวิจัยล่าสุดที่กลุ่ม Fraunhofer ISE and ISFH ได้พัฒนาหลักการ BC-BJ (Back-contact back junction) ที่เน้นต้นทุนการผลิตต่ำกว่านั้นให้ ประสิทธิภาพดีที่สุดที่ 21.3% [F. Granek, et. al 2009]



รูปที่ 1.4 เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงชนิดซิลิคอนในโครงสร้างแบบ PERL (Passivated Emitter, Rear Locally-diffusion cells) [J. Zhoa, M.A. Green, et. al, (1996)]

ถึงแม้ว่าการทำพาสซิเวชันที่ผิวในรูปแบบหลักการที่แตกต่างกันเพื่อให้ประสิทธิภาพการแปลง พลังงานที่สูงเข้าใกล้ค่าจำกัดสูงสุดของเซลล์ชนิดซิลิคอน แต่กระบวนการผลิตทั้งหมดก็ยังต้องพึ่งพา เทคโนโลยีของ Photolithography และเลเซอร์ ยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพสูงกว่า 25% ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนและยุ่งยาก และมีราคาต้นทุนการผลิตสูง ใน โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์แบบ PERL มีส่วนประกอบหลักที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เกินกว่า 25% สามารถพิจารณาเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

 การสร้างชั้นป้องกันการสะท้อนแสงแบบสองชั้น (Dual anti-reflection layer, DARL) เพื่อ ลด %R ตลอดย่านแสง Visible ทำให้ประสิทธภาพเชิงควอนตัมสูงขึ้น จากการสร้างชั้น SiN_x และ SiN_xO_y

2. การสร้างบริเวณ Selective Emitter (SE) ของชั้นรับแสงให้มีค่าความต้านทานไฟฟ้าแผ่น (Sheet resistivity, ρ_{sheet}) ที่แตกต่างกัน แสดงในรูปที่ 1.5 โดยที่บริเวณรับแสงให้มีค่าสูงแต่ไม่เกิน 120 Ω /sheet และบริเวณใต้ขั้วไฟฟ้ากริดให้มีค่า ρ_{sheet} ต่ำ ๆ เพื่อให้เกิดความต้านทานไฟฟ้าที่รอยสัมผัส (Contact resistance, R_c) ส่งผลให้ความต้านทานอนุกรม (Series resistance, R_s) ลดลง และ Fill factor (FF) สูงขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงขึ้น



รูปที่ 1.5 บริเวณการตอบสนองแสงคลื่นสั้นและคลื่นยาวของเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง Selective emitter

3. การสร้างชั้นออกไซด์แบบจุดสัมผัส หรือเรียกว่าการเปิดช่องออกไซด์ เพื่อให้เกิดบริเวณ LBSF เกิดสนามไฟฟ้าที่ด้านหลังสูง ลดผลของความต้านทานที่รอยสัมผัสระหว่างชั้นออกไซด์และซิลิคอน ส่งผลให้ ค่า V_{oc} ค่า FF และค่า I_{sc} ของเซลล์สูงขึ้น

โดยทั่วไปจุดประสงค์หลักของการเปิดช่องออกไซด์ด้านหลังเซลล์ หรือการสร้างบริเวณ Selective emitter ไม่ได้มุ่งไปสู่การทำลวดลายที่มีขนาดเล็กกว่าไมครอน ดังนั้นเทคนิคการประทับลาย (stamp) จึง เป็นเทคนิคทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างลวดลายฟิล์มบางภายในกระบวนการเดียว ผลิตซ้ำได้จำนวนมากใน เวลาสั้น อีกทั้งชุด Stamp มีอายุการใช้งานได้นาน สามารถออกแบบเพื่อให้ได้ขนาด และลวดลายที่คมชัด สำหรับโครงงานวิจัยนี้มีแนวคิดสร้างชุด Stamp ให้มีลวดลายที่เหมาะสมสำหรับการเปิดช่อง SiO₂ เพื่อ สร้างเป็นชั้น Localized passivation ให้แก่เซลล์แสงอาทิตย์ อีกทั้งเป็นแนวคิดใหม่ในการทำลายกำแพง หรือข้อจำกัดในการนำเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง PERL ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเข้าสู่การผลิตใน อุตสาหกรรม การศึกษานี้จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการแปลง พลังงานสูงของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนการผลิตด่ำ

ดังนั้นผู้เสนอโครงการจึงมีแนวคิดนำเทคนิคการประทับลาย (Stamping technique) ซึ่งเป็น เทคนิคทางเลือกใหม่ไม่เพียงเป็นเทคนิคที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้เวลาสั้น ผลิตลวดลายช่องเปิดชั้นออกไซด์ พาซิเวชันได้ปริมาณมากแล้วยังสามารถพัฒนาได้ลวดลายที่คมชัด สม่ำเสมอ สะดวก และรวดเร็ว ใช้วัสดุ สารละลายที่สามารถสังเคราะห์เองได้ หรือสารละลาย Resist ทั่วไปในปริมาณน้อยกว่า ไม่เหลือทิ้ง อีกทั้ง ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถบูรณการองค์ความรู้ของการพัฒนาใช้เทคนิค Stamp ไปสู่กระบวนการ ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชได้ในอนาคต เทคนิค Stamp ยังสามารถสร้างลวดลายได้หลายชั้นซึ่ง หลักการใหม่นี้มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฟิล์มบางให้สะดวก และง่ายขึ้นทั้งใน ระดับวิจัย ได้ใช้เทคนิค Stamp เพื่อสร้างลวดลายขนาดเล็ก ลดกระบวนการของ Photolithography ยกตัวอย่างเช่นได้มีการวิจัยสร้างชุด PDMS stamp สำหรับการผลิตอุปกรณ์แสดงผลเป็นแผ่นม้วน [S. Y Hwang et.al., 2009] การสร้างรูปแบบผิวไม่เรียบที่แผ่นฐานกระจกเพื่อลดผลการสะท้อนแสงกลับให้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิลม์บาง [K. S Han, 2010] การสร้างผิวแผ่นฐานซิลิคอนให้เกิดโครงสร้างขรุขระทรง พีระมิดขนาดเล็กสม่ำเสมอด้วยการสร้างเปิดช่องลวดลายของ Photoresist เพื่อให้เกิดการสกัดผิวแบบ Isotropic etching ส่งผลให้เกิดการสะท้อนกลับลดลง [S. Landis, 2013] อย่างไรก็ตามการนำเทคนิค stamp มาใช้เพื่อสร้างชั้น Localized passivation ยังไม่มีผลรายงาน

สำหรับโครงงานวิจัยนี้มีแนวคิดการนำเทคนิค Stamp สารละลาย HF ที่มีรูปแบบของลวดลาย ขนาดไมโครเมตร เพื่อประทับสารละลายสกัดบริเวณฟิล์ม SiO₂ ให้เกิดลวดลายเปิดช่องตามต้องการบน ฐานของแข็งเรียบอย่างแผ่นซิลิคอนได้ภายใต้อุณหภูมิห้อง เกิดเป็นช่องเปิดไดอิเล็กตริกสำหรับพาสซิเวชัน ที่ผิว จากหลักการดังกล่าวจะให้ประโยชน์ในส่วนของกระบวนการผลิต ที่ง่ายขึ้น และรวดเร็วขึ้น ลดต้นทุน ได้มากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้กันในปัจจุบัน อีกทั้งการศึกษานี้จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ สำคัญสำหรับวิศวกรรมเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาใช้งานได้ในเชิงพาณิชต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 สนับสนุนการวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนจากการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดซิลิคอนด้วยเทคนิคที่มีต้นทุนการผลิ<mark>ตต่ำ เพื่อเพิ่มความเข้ม</mark>แข็งด้านการวิจัยพลังงานในประเทศ

1.2.2 เพื่อหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีของสร้างชุดประทับลาย (Stamp) เพื่อลดกระบวนการ สร้างลวดลายขนาดเล็กที่มีความซับซ้อน และเพื่อศักยภาพการผลิตในปริมาณมากในกระบวนการผลิตเซลล์ แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง

 1.2.3 เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อก้าวสู่นวัตกรรมทาง วิศวกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในแบบแผนใหม่

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 กระบวนทำลวดลายช่องเปิดไดอิเล็กทริกที่เหมาะสมสำหรับจุดสัมผัสออกไซด์เพื่อสร้างชั้น พาสซิเวชันให้แก่เซลล์แสงอาทิตย์

1.3.2 สร้างชั้นพาสซิเวชันที่ผิวด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเทคนิค Stamp

 1.3.3 ศึกษาวิธีและทำการทดสอบคุณภาพทางอิเล็กทรอนิกส์-แสง และไฟฟ้าชั้นเปิดช่องพาสซิเว ชันที่สร้างขึ้นกับเซลล์แสงอาทิตย์

1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

1.4.1 ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการจากหนังสือ วารสารวิชาการ สิทธิบัตร และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Literature Survey)

1.4.2 ศึกษาแบบแผนของโครงสร้างชั้นพาสซิเวชันด้านหลังเพื่อให้เกิดคุณภาพการพาสซิเวชันที่ ผิวที่ดีและเหมาะสมกับโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์

1.4.3 ศึกษากลไกการสร้างชุด Stamp ที่มีประสิทธิภาพ และการประทับสร้างลวดลายชั้นพาส ซิเวชันด้านหลังด้วยเทคนิค Stamp

1.4.4 สร้างชั้นรอยต่อพี-เอ็นสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ และสร้างชั้น SiO₂ บาง ๆ และศึกษาการ ทดสอบประทับลาย 2 วิธีคือสร้างลวดลายผ่านกระบวนการ Photoresist etching และสร้างลวดลายเปิด ช่อง SiO₂ ได้โดยตรง

 1.4.5 ทดลองวัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นคุณสมบัติขั้วไฟฟ้าโอห์มมิค ค่าความต้านทานอนุกรมค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวสัมผัส ค่าช่วงชีวิตของพาหะ เพื่อให้เกิดคุณภาพการ พาสซิเวชันที่ผิวที่ดีและเหมาะสมกับโครงสร้<mark>างเซ</mark>ลล์แสงอาทิตย์

1.4.6 ตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างของชั้นพาสซิเวชันด้วยการวัดโครงสร้างด้วยเครื่องวัด กำลังขยายสูงด้วยอิเล็กตรอน (SEM) เพื่อวิเคราะห์ร่วมกับผลการวัดทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

1.4.7 ทดสอบวัดประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์ที่ผลิตได้จริง และจากการจำลองด้วย โปรแกรมคณิตศาสตร์ PC1D

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1.5.1 เป็นองค์ความรู้ในการแนวทางใหม่สำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนแบบ
 LBSF ด้วยเทคนิค Stamp ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีเลเซอร์ และระบบสุญญากาศพิเศษ เพื่อ
 ลดต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

1.5.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสารทาง วิชาการ ดังนี้

กมลชนก เมฆหมอก วรากร ลิ้มศิริ และ **ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์** "การสร้างชั้น Local Back Surface Field (LBSF) ที่ด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนโดยวิธีการประทับลายด้วย Flash foam" การประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 13-15 มิถุนายน 2561 จ.ระยอง หน้า 791-794 A. Mangkornkaew and **T. Fangsuwannarak**, Characterization of patterns of Localized Doping Using Stamping technique for Selective n-Emitter Solar Cell Structure, Materials Science and Engineering 241, 012042 (2017)

1.5.3 ผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สำเร็จในปีการศึกษา 2560
 ได้ 1 คนที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะในการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่ได้



บทที่ 2

การออกแบบและสร้างเครื่องประทับลายสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์

2.1 บทนำ

การศึกษาเทคนิคใหม่ของการเปิดช่องไดอิเล็กทริคให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน ประสิทธิภาพสูงของงานวิจัยนี้ ได้ใช้แนวคิดแบบใหม่จากการใช้วิธีการประทับลวดลายสารละลายด้วยแผ่น Flash foam สำหรับเปิดช่องให้กับเซลล์แสงอาทิตย์เป็นครั้งแรก โดยไม่พึ่งพาเทคนิคโฟโตลิโทรกราฟีที่มี ขั้นตอนการผลิตชับซ้อน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรม ปัจจุบันมี การใช้เทคนิคเลเซอร์เปิดช่องไดอิเล็กทริก ซึ่งมีข้อดีในแง่การผลิตที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและความแม่นยำ ถูกต้อง แต่ต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตฟิล์มบางของอะลูมิเนียมออกไซด์เพิ่มขึ้นในโครงสร้างสำหรับป้องกัน การเกิดจุดบกพร่องและเป็นแหล่งสารเจือในบริเวณที่เปิดช่องไดอิเล็กทริก ดังนั้นวิธีการเปิดช่องไดอิเล็กท ริกด้วยการประทับลวดลายของสารละลายสกัดผิวำดอิเล็กทริก จึงเป็นทางเลือกของการผลิตเซลล์ แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ที่ประกอบด้วยบริเวณแพร่สารเจือในบริเวณหรือลวดลายที่ต้องการ ที่มีต้นทุน การผลิตต่ำ และมีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน

2.2 การออกแบบเครื่องประทั<mark>บลา</mark>ยกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Solid work ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ส่วนหลัก ๆ คือ

 1. ชุดโครง และ ฐานรองยึดชิ้นงาน โดยที่แผ่นฐานของเครื่องใช้แผ่นอะลูมิเนียม หนา 10 cm และแผ่นรองรับแผ่นซิลิคอนใช้วัสดุ POM

2. ระบบขับเคลื่อนหัวประทับลาย ด้วยมอเตอร์แบบสเตปเปอร์ NEMA 17 พิกัด 24V 2A

3. ชุดไฟฟ้าและระบบควบคุมการประทับลาย ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด 24V 3A

4. ชุดหัวประทับลายจากวัสดุ Flash foam เป็นวัสดุโพลิเมอร์มีลักษณะเป็นโฟมมีรูพลุน และมี คุณสมบัติเช่นเดียวกับสารไวแสง หรือ Photo resist

ภาพของเครื่องประทับลายที่ออกแบบแสดงในรูปที่ 2.1 และตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดของ ชิ้นส่วน แบบและขนาดเขียนด้วยโปรแกรม Solid work รูปที่ 2.2 แสดงภาพของเครื่องที่ประกอบสมบรูณ์

รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของเครื่องปร<mark>ะ</mark>ทับลายต้นแบบ

No.	ชื่อส่วนประกอบ	ลักษณะ	หน้าที่	ຈຳนวน
1	ฐานล่าง	อะ <mark>ลูมิเนียมสี่เหลี่ยมตัน</mark>	<mark>สำหรับรองเส</mark> า และรองปอม	1
	(Base plate)		19	
2	ขา (Leg)	เหล็กทรงกลมกลวง	สำหรับต่อข้างใต้ฐานล่าง เพื่อให้	4
		<i>่าชา</i> ลยเทคโ	ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย	
3	เสา (Post)	เหล็กกลมตัน	ทำเกรียวสำหรับยึดฐานล่างกับฐาน	2
			บน	
4	ตัวยึดเสา	แผ่นอะลูมิเนียม	ติดกับแบริ่งที่ใช้ยึดกับเสาเพื่อให้	1
	(Locking post)		เป็นแนวเคลื่อนที่ขึ้นลงตรงกลาง	
			เจอะรูเพื่อติดกับบอล	
5	ฐานบน	อะลูมิเนียมแผ่นสี่เหลี่ยม	ใช้ยึดเสาด้านบนกับ เป็นช่องใส่	1
	(Base on)		แกนของบอลสกรู	

d		
ตารางที่ 2.1	ส่วนประกอบต่างๆ ของเ	ครื่องประทับลาย

6	บอล (Ball)	เหล็กทรงกลม	ใช้สำหรับใส่ลูกปืนเพื่อให้สกรู	1
			เคลื่อนที่สะดวก	
7	สเต็ปเปอร์	มอเตอร์รูปทรงสีเหลี่ยม	ใช้ขับบอลสกรู ควบคุมโดยใช้	1
	มอเตอร์		ไมโครคอนโทลเลอร์ Aduino ใน	
	(Stepper motor		การสั่งบอร์ดให้ไปขับสเต็ปมอเตอร์	
			รุ่น NEMA 17	
8	สกรู (Screw)	เหล็กเกลียว	เป็นแกนยึดกับหัวประทับลาย ใช้	1
			ในการเคลื่อนที่ขึ้นลง	
9	ที่รองสำหรับ	อะคริลิคแผ่นสี่เหลี่ยม	เจาะรูสำหรับเปลี่ยนขนาดของหัว	1
	เปลี่ยนหัวประทับ		ประทับลาย	
	ลาย (Pad			
	stamped)	Πη		
10	โบล์ ขนาด	มีรูขนาดเส้นผ่ <mark>าศูน</mark> ย์กลาง	ใ ช้สำหรับยึดหัวประทับลายกับตัว	4
	M4x20 (Blots	4 mm ยาว 2 <mark>0 m</mark> m	ยึดเสา	
	M4x20)		H	
11	นัท M4 (Nut	มีรูตรงก <mark>ลางเ</mark> ป็นเกลียว	ที่ไว้ใส่กับโบล์ M4	8
	M4)	ขนา <mark>ด</mark> 4 mm		
12	แบริ่ง 1 (Bearing	เห <mark>ล็ก</mark> ทรงกลมกลวงมี	<mark>เป็นตัวที่ติดกับต</mark> ัวยึดเสา ลดแรง	1
	1)	ลู <mark>กปืนอยู่</mark> ข้างใน	ต้านขณะเ <mark>คลื่อน</mark> ที่	
13	แบริ่ง 2 (Bearing	เหล็ก <mark>ทรงกลมกลวงมี</mark>	<mark>เป็นตัวที่ติดกั</mark> บตัวยึดเสา ลดแรง	1
	2)	ลูกปืนอยู่ข้างใน	<mark>ต้านขณะเคลื่อนที่</mark>	
14	แบริ่ง 3 (Bearing	เหล็กทรงกลมกลวงมี	เป็นตัวที่ยึดติดกับกับแกนสกรู	1
	3)	ลูกปืนอยู่ข้างใน	ด้านล่าง	
15	ฐานลองเกียร์	เหล็กทรงกลมกลวงมี	เป็นแบริ่งขนาดใหญ่ที่ใช้ต่อกับ	1
	(Base gear)	ลูกปืนอยู่ข้างใน	เกียร์และยึดกับฐานบน ลดแรงต้าน	
			ขณะเคลื่อนที่	
16	เกียร์ 1 (Gear 1)	เหล็กทรงกลมมีเฟือง 18	เป็นเกียร์ที่ใช้ติดกับฐานบนกับบอล	1
		ച്ച്	สกรู	
17	เกียร์ 2 (Gear 2)	เหล็กทรงกลมมีเฟือง 10	เป็นเกียร์ที่ติดกับแกนของสเต็ป	1
		- 1 1 1	เปอร์มอเตอร์	

18	ที่สวมเกียร์(Gear	์สวมเกียร์(Gear เหล็กเกลียวเจาะรูตรง เป็นที่สวมเกียร์กับสเต็ปเปอร์		1
	shaft)	กลาง มอเตอร์ให้ยึดติดกัน		
19	ฐานลองมอเตอร์	อะลูมิเนียมฉาก เป็นฐานใช้รองมอเตอร์ เพื่อปรับ		1
	(Pad motor)		ระยะที่ให้เสถียร	
20	หัวประทับลาย	POM สี่เหลี่ยม สกัดลาย	มีลักษณะสี่เหลี่ยม มีช่องสำหรับใส่	1
	(Stamped)	CNC ด้านล่าง	Flash foam	
21	ตัวหนอน M4x10	เป็นเกลียวแท่ง มีขนาด	ใช้สำหรับยึดหัวประทับลายกับที่	4
	(Socket set	เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 mm	รองสำหรับเปลี่ยนหัวประทับลาย	
	screw M4x10)	ยาว 10 mm		
22	ฐานรองแผ่น	อะคริลิคแผ่นสี่เหลี่ยม	ใช้สำหรับรองฐานรองแผ่น POM	1
	POM สำหรับดูด	η η	สำหรับดูดสุญญากาศ เพื่อไม่ให้	
	สุญญากาศ (Pad		แผ่นมีลมรั่ว	
	POM)	H S.	4	
23	แผ่น POM ต่อ	POM แผ่นสี่เ <mark>หลี่</mark> ยมสกัด	<mark>เพื่อ</mark> ยึดแผ่นซิลิคอนด้วยการดูด	1
	ร่วมกับระบบดูด	รองด้วย C <mark>NC</mark> เพื่อยึดแผ่น	สุญ <mark>ญา</mark> กาศ	
	สุญญากาศ	ซิลิคอ <mark>นด้</mark> วยการดูด		
		สุญญากาศ		
24	ท่อ พีวีซี (PVC)	ท่ <mark>อพีวีซีทรงกลมกลวง</mark>	สำหรับต่อกับหัวต่อกับเครื่องดูด	1
			สุญญากาศ	
25	หัวต่อลม (Quick	เหล็ก <mark>ทรงกลมกลวงมีช่อง</mark>	<mark>เป็นตัวที่ใช้ส</mark> ำหรับต่อกับเครื่องดูด	1
	coupler)	สำหรับยึดสายท่อลม	สุญญากาศ	
		Shan-	Indias ^V	
	1	าวาสยากคโ	UIGOS	

รูปที่ 2.2 แสดงภาพเครื่องประทับลวดลายกึ่งอัตโนมัติ ในส่วนของชุดหัวประทับลายเพื่อบรรจุแผ่น Flash foam แสดงแบบในรูปที่ 2.3 ได้ทำการสกัดเป็นร่องด้วย CNC รูปที่ 2.4 แสดงแผ่นฐานรองแผ่น ซิลิคอน สกัดรูเล็ก ๆ และประกบกับแผ่นอะคริลิค ในรูปที่ 2.5 และเชื่อมให้ 2 แผ่นติดกันด้วยซิลิโคนติด รอบ ๆ ขอบแผ่น รูของแผ่นในรูปที่ 2.5 จะต่อร่วมกับระบบดูดสุญญากาศต่อไป การต่อระบบสุญญากาศ เข้ากับชุดแผ่นรองเซลล์ซิลิคอน ได้ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ ยี่ห้อ GAST รุ่น DOA-P604-BN ที่ระดับ 0 – 160 psi ต่อร่วมกับชุดแผ่น POM – อะคริลิค เพื่อยึดแผ่นเซลล์ไม่ให้เคลื่อนที่ขณะประทับลวดลายของ สารละลายที่ต้องการลงบนแผ่นเซลล์ แสดงเครื่องประทับลาย ชุดควบคุมสต์ปมอเตอร์ และเครื่องดูด สุญญากาศในรูปที่ 2.6

ร**ูปที่ 2.2** เครื่องประทับลาย<mark>กึ่งอัต</mark>โนมัติ

รูปที่ 2.3 ชุดหัวบรรจุแผ่น Flash foam

รูปที่ 2.5 แผ่นอะคริลิคสำหรับรองแผ่น POM และต่อร่วมกับท่อดูดสุญญากาศ

รูปที่ 2.6 เครื่องประทับลาย ชุด<mark>ค</mark>วบคุมส<mark>ต</mark>์ปมอเตอร์ และเครื่องดูดสุญญากาศ

2.3 การเลือกขนาดของสเต็ปมอเ<mark>ตอร์</mark>และการออก<mark>แบบว</mark>งจรไฟฟ้า

ก่อนทำการเลือกขนาดของสเต็ปมอเตอร์ ได้ทดสอบการประทับลายด้วยการกดด้วยแรงคน ซึ่งจะ ได้แรงกด (F) เริ่มต้นค่าหนึ่งและคำนวณเป็นค่าแรงบิด(Torque) และนำค่าดังกล่าวไปเลือกค่าแรงบิดของ มอเตอร์ที่ขายตามท้องตลาด โดยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของสเต็ปมอเตอร์ได้แก่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ที่ควบคุมความเร็วและการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ และวงจรขับสเต็ปเปอร์ มอเตอร์ ที่รับสัญญาณ PWM (Pulse width modulation) จากไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3.1 การคำนวณหาขนาดของสเต็ปมอเตอร์

จากการทดลองประทับลายด้วยมือ แรงกดที่ได้ลวดลายจากการประทับลายมีค่าประมาณ 5 N และกำหนดให้ค่าแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.81 m/s² จะได้น้ำหนักของแรงกด ดังสมการที่ (2.1)

$$m = \frac{F}{g} = \frac{5 N}{9.81 m/s^2} = 0.51 kg$$
(2.1)

โดยที่ m คือ น้ำหนักของแรงกด (kg)

F คือ แรงในการกด *(*N*)*

g คือ แรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.81 m/s²

การคำนวณหาค่าแรงบิด ได้กำหนดแฟคเตอร์เท่ากับ 10 เท่า ทำให้ได้น้ำหนักแรงกดเท่ากับ 5.1 kg จากนั้นคำนวณแรงในการกดจะได้เท่ากับ 50 N ซึ่งค่าที่ได้จากการเผื่อโหลด จะสามารถนำมาหาค่า แรงบิดได้จากสมการที่ (2.2)

$$T = \frac{Fp}{2\pi e} = \frac{50 N \times 2 mm}{2 \times \pi \times 0.8} = 0.02 N.m$$
(2.2)

โดยที่ T คือ แรงบิดที่เกิดขึ้น

F คือ แรงกดที่เอาชนะแรงเสียดทาน (N)

p คือ ระยะ Picth ของบอลสกรู (Nm)

e คือ ประสิทธิภาพของบอลสกรู (80%)

ดังนั้นจึงเลือกสเต็ปมอเตอร์ที่มีค่าแรงบิดมากกว่า 0.02 N.m เลือกใช้สเต็ปมอเตอร์ รุ่น NEMA ที่ มีค่าแรงบิดอยู่ที่ 0.48 N.m พิกัด 24V 2A

2.3.2 การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

การออกแบบแหล่งจ่ายตามพิกัดของมอเตอร์ ดังนั้นจึงต้องเลือกหม้อแปลงที่มีขนาด 24v 3A และ ออกแบบวงจรไฟฟ้าและจำลองการทดสอบผ่านโปรแกรม Proteus รูปที่ 2.7 แสดงแบบวงจรของแหล่งจ่าย ไฟฟ้า

รูปที่ 2.7 วงจรไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ขนาด 24∨ 3A

2.3.3 วงจรควบคุมสเต็ปมอเตอร์

การควบคุมสเต็ปมอเตอร์พิจารณา 2 ส่วนคือ การควบคุมความเร็วของสเต็ปมอเตอร์ และการ ควบคุมทิศทางการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็นตัวที่ควบคุมการ ทำงาน การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ใช้วิธี PWM (Pulse width modulation) โดยการสร้างพัลส์รูป สี่เหลี่ยมให้มีเวลาของการเปิดและปิด (Duty cycle) ขนาดต่างๆ ซึ่งถ้าให้ช่วงเวลาของการเปิดมาก จะทำ ให้มอเตอร์มีความเร็วในการหมุนที่เร็วมากขึ้นตามไปด้วย โดยพัลส์ที่กล่าวมานั้นจะมาจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซึ่งการควบคุมการหมุน สั่งได้โดยการใส่เครื่องหมายลบ (-) หน้าค่า PWM (Pulse width modulation) ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะได้ทิศทางอีกด้านหนึ่งหนึ่ง ซึ่งสัญญาณ PWM จะ เป็นค่าที่ป้อนให้บอร์ดขับสเต็ปมอเตอร์ทำงาน โดยมีลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ควบคุมสเต็ปมอเตอร์ แสดงดังรูปที่ 2.8

การป้อนค่าควบคุมการทำงานของเครื่องประทับลายนั้นได้ใช้วิธีป้อนค่าเป็นตัวเลขให้ทำงานตาม ต้องการ โดยใช้ปุ่มกด Keypad 4x3 ในการป้อนค่าและใช้จอแสดงผลแอลซีดี (Liquid crystal, LCD) ใน การแสดงผล เพื่อเลือกกำหนดค่าที่เหมาะสมสำหรับการกดประทับลวดลาย เนื่องจากลวดลายที่ประทับมี ขนาดแตกต่างกัน ดังนั้นจึงใช้ระดับการกดที่แตกต่างกัน

การออกแบบเขียน Code คำสั่งเพื่อควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์ใช้โปรแกรม Aduino ในการเขียน โดยสามารถป้อนระยะทางเคลื่อนที่ของหัวประทับลายในระดับต่าง ๆ ตามคำสั่งที่เขียนกำหนดได้ 64 steps และเมื่อถึงระยะประทับลวดลายสามารถกำหนดเลือกเวลาการแช่ค้างไว้ได้ไม่เกิน 1 นาที

รูปที่ 2.8 การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ควบคุมสเต็ปมอเตอร์

2.4 สรุป

งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องประทับลายต้นแบบสำหรับการผลิตเซลล์ แสงอาทิตย์ เครื่องสามารถปรับระดับหัวประทับบนชิ้นงานได้หลายระดับ ขึ้นกับขนาดของลวดลาย และ สารละลายที่ถ่ายทอดลวดลายลงบนชิ้นงาน ชุดหัวประทับลายสามารถสวมประกอบร่วมกับแผ่น Flash foam และสามารถเปลี่ยนขนาดพื้นที่ใหญ่ได้

บทที่ 3

การทดสอบประทับลวดลายสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์

3.1 บทนำ

การเปิดช่องไดอิเล็กทริคของเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง Local Back Surface Field (LBSF) โดย ปกติพิจารณาสัดส่วนของการเปิดช่องต่อพื้นที่ทั้งหมด (Aperture ratio) เป็นหลักมากกว่าการพิจาณาเพียง ขนาดของช่องเปิดซึ่งอาจมีขนาดใหญ่ จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้วิธีโฟโตลิโทรกราฟี เมื่อพิจารณา โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง Selective emitter ดังนั้นวิธีการประทับลายในงานวิจัยจึงเป็น การศึกษาครั้งแรกเลือกใช้การผลิตลวดลายขนาดใหญ่ระดับ 100 ไมครอนขึ้นไป สำหรับการประยุต์ในเซลล์ แสงอาทิตย์ซิลิคอน ในนบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะทางโครงสร้างของ Flash foam การสร้างลวดลายของ ฟิล์มซิลิคอนไดออกไซด์ และลวดลายของฟิล์มสารละลลายโบรอนสำหรับโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ LBSF รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะของลวดลายที่เกิดขึ้น

3.2 ลักษณะพื้นผิวของแผ่น Flash foam

Flash foam เป็นวัสดุโพริเมอร์ไวแสงประเภท poly-imide ชนิดหนึ่ง ความหนาสามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสมเพื่อดูดซับสารละลายในปริมาณที่แตกต่างกัน ลักษณะพื้นผิวของแผ่นสามารถวิเคราะห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ขยายด้วยวิธียิงลำอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy, SEM) จากเครื่อง JEOL รุ่น j6010LV โครงสร้าง Flash foam ในสภาพปกติมีลักษณะเป็นรูพรุนแสดงในรูป ที่ 3.1(ก) และ (ข)

ร**ูปที่ 3.1 (ก)** โครงสร้างพื้นผิวของ Flash foam ที่กำลังขยาย 300 เท่า และ (ข) ที่กำลังขยาย 2000 เท่า

เทคนิคการประทับลายได้เลือกใช้ Flash foam ที่เป็นวัสดุพอลิเมอร์ไวแสง เมื่อมีแสงแฟลชส่อง ผ่านจะเกิดปฏิกิริยาทำให้พอลิเมอร์ที่มีลักษณะรูพรุนละลาย และเชื่อมต่อกัน ลวดลายบนแผ่น Flash foam สามารถสร้างได้ตามแบบลวดลายของหน้ากาก ซึ่งแผ่น Flash foam มีลักษณะที่เป็นรูพรุนที่ สามารถดูดซับสารละลาย เพื่อใช้สำหรับการประทับลายของสารละลายที่ต้องการได้ แสดงพื้นผิวของ Flash foam ในรูปที่ 1 โดยการสร้าง Flash foam ประทับลายได้ใช้เครื่อง Flash รุ่น JL-V มีแหล่งกำเนิด แสงแฟลซจำนวน 5 หลอด แสดงดังรูปที่ 3.2 ในขั้นแรกเริ่มจากการออกแบบลวดลายหน้ากากทึบแสง ป้องกันแสงแฟลซตามที่ต้องการ จากนั้นนำ Flash foam และแบบลวดลายหน้ากากที่เตรียมไว้เข้าเครื่อง Flash Stamp แสงแฟรซจะทำปฏิกิริยากับ Flash foam ซึ่งจะได้ลวดลายเป็นลักษณะบริเวณลายเปิดและ ลายปิดตามที่ออกแบบไว้ ดังแสดงในรูปที่ 2 ขนาดที่ Flash foam สามารถผลิตเล็กที่สุดได้ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 μm

ร**ูปที่ 3.2** ภาพถ่าย (ก) เครื่อง <mark>Flas</mark>h Stamp รุ่น JL-V และ (ข) หลอดแฟลชภายในเครื่อง

3.2.1 การสร้างลวดลายสารไวแสงด้วย Foam stamp

การศึกษาลวดลายในขั้นต้นใช้ลวดลายหน้ากากปิดแสงลักษณะแบบขั้วไฟฟ้ากริด มีขนาด Bus bar กว้างเท่ากับ 1000 μm และบริเวณ Finger มีขนาดกว้างเท่ากับ 500 μm แสดงในรูปที่ 3.3 โดยได้ ออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่าแบบของขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อประทับสารไวแสง (Photo resist) ในบริเวณลวดลายขั้วไฟฟ้า จากนั้นนำหน้ากกากที่เตรียมไว้วางบนแผ่น Foam ไวแสงและเข้าเครื่อง Flash Stamp เป็นเวลาไม่กี่วินาที จะได้ลวดลายบน Foam Stamp แสดงดังรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.3 ลวดลายหน้ากากปิดแสงลักษณะแบบขั้วไฟฟ้ากริด

ร**ูปที่ 3.4 (ก)** ลักษณะของลวดลายที่เกิดขึ้นบน Fo<mark>am</mark> stamp และ **(ข)** ภาพขยายกำลังขยาย 50 เท่า

รูปที่ 3.4 แสดงลวดลายที่เกิดขึ้นบน Foam stamp จากผลพบว่าลวดลายเกิดขึ้นมีลักษณะ เช่นเดียวกับแบบตามรูปที่ 3.3 และเมื่อวัดขนาดลวดลายของ Bus bar ที่เกิดขึ้นบน Foam stamp พบว่ามี ขนาดเท่ากับ 1080.56 µm ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแบบประมาณ 8.05 % และขนาดของ Finger วัดได้ 542.38 µm ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแบบประมาณ 8.41 % หลังจากนั้นให้ Foam stamp ดูดซับสารไวแสง และสวมเข้ากับหัวเครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติ

รูปที่ 3.5 แสดงภาพลวดลายสารไวแสงพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นบนชั้น n⁺⁺ Si หลังการประทับลาย ซึ่ง สารไวแสงนี้ทำหน้าที่เป็นหน้ากากป้องกันการสกัดพื้นผิวซิลิคอนในกระบวนการสกัดเคมี Etching back หลังจากที่ถูกประทับลวดลายแล้ว ได้ทำการวัดขนาดของลวดลายที่เกิดขึ้นพบว่า Bus bar มีขนาดประมาณ 999.12 μm ซึ่งมีขนาดลดลงจากแบบที่ออกแบบไว้ 0.09 % และขนาดของ Finger วัดได้ประมาณ 513.36 µm พบว่ามีขนาดใหญ่กว่าแบบที่ออกแบบไว้ 2.67 % จากผลแสดงให้เห็นว่าลวดลายสารไวแสงมีความ คลาดเคลื่อนจากต้นแบบไม่เกิน 3% บ่งบอกให้เห็นว่าวิธีการประทับลายสามารถใช้ได้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ ได้เช่นกัน เมื่อนำแผ่นซิลิคอนที่ถูกประทับลวดลายด้วยสารไวแสง และนำไปผ่านกระบวนการสกัด เคมี Etching back ด้วยการแช่ HF นาน 15 วินาที เพื่อให้ส่วนของชั้น n⁺⁺ Si ถูก Etched back ทำให้ค่า ความต้านทานไฟฟ้าแผ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งค่านี้จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา Etched back ที่นานขึ้น จากผลพบว่า ขนาดของลวดลายสารไวแสงบริเวณ Bus bar วัดได้ 928.74 µm ซึ่งมีขนาดลดลงประมาณ 7.13 % และ บริเวณ Finger วัดขนาดได้ประมาณ 398.82 µm ซึ่งมีขนาดลดลงจากแบบที่ออกแบบไว้ประมาณ 20.24 % ลวดลายสารไวแสงที่ผ่านการ Etching back แสดงดังรูปที่ 3.6 จากขนาดที่ลดลงสามารถออกแบบ ลวดลายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อชดเชยผลการสกัดที่ขอบของลายเส้น

ร**ูปที่ 3.6 (ก)** ลวดลายหลังจากผ่านการ Etching back และ (ข) ภาพถ่ายลักษณะลวดลายหลังจากผ่าน การEtching back ที่กำลังขยาย 50 เท่า

3.2.2 การสร้างลวดลาย Borosilicate ด้วย Foam stamp

ในงานวิจัยได้ทดสอบการประทับลายของ Borosilicate glass (BSG) ด้วยการใช้สารละลาย ประกอบโบรอนเข้มข้นสูงที่เตรียมในห้องปฏิบัติการ สำหรับเป็นแหล่งสารเจือโบรอน เพื่อได้บริเวณ p⁺⁺ region หลังกระบวนการแพร่ที่อุณภูมิสูง ที่ด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF แสดงโครงสร้าง เซลล์ดังรูปที่ 3.7 ค่า Aperture ratio เป็นอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ช่องเปิด p⁺⁺ region กับระยะห่าง ระหว่างช่องเปิด ซึ่งมีผลต่ออัตราการรามตัวใหม่ที่ผิวและค่าช่วงชีวิตของพาหะในเซลล์แสงอาทิตย์ ขณะเดียวกันขนาดของบริเวณ p⁺⁺ region ยังมีผลต่อตัวแปรทางไฟฟ้าต่าง ๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์เช่นกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ทดสอบการประทับลวดลายสารละลายโบรอนในขนาดต่าง ๆ

ร**ูปที่ 3.7** โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ LBSF

ในขั้นตอนแรกนำแผ่นฐานผลึกโพลีซิลิคอนชนิด p-type ขนาด 3x3 cm² มีความต้านทานไฟฟ้า จำเพาะระหว่าง 1-3 โอห์มเซนติเมตร ความหนา 200 µm นำมากำจัดชั้นออกไซด์ (Native oxide) ด้วย กรดไฮโดรฟลูออริก (Hydrofluoric acid) เข้มข้น 5% เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิว ด้วยวิธี RCA ต่อมาทำการประทับลายสารละลายประกอบโบรอนด้วยเครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติ ใน รูปแบบลายเส้นที่ด้านหลังของแผ่นฐาน p-Si โดยมีความกว้างของลายโบรอนประมาณ 250 µm และมี Aperture ratio ที่ 100, 50, 20, 15, 10 และ 5% ทำการอบลวดลายโบรอนที่ประทับได้ที่อุณหภูมิ 200 ℃ จากนั้นอบที่อุณหภูมิสูงประมมาณ 1150℃ เป็นเวลา 30 นาที ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนบริสุทธิ์ เพื่อให้สารเจือโบรอนแพร่ในบริเวณลวดลายที่ต้องการ

ร**ูปที่ 3.8** ลวดลายฟิล์ม BSG บนแผ่นฐาน p-Si ด้วยการประทับลาย **(ก)** ลวดลายขนาด 100 μm **(ข)** ขนาด 250 μm และ **(ค)** ขนาด 500 μm และลวดลายแบบจุดขนาด **(ง)** 250 μm **(จ)** 500 μm และ **(ฉ)** 1000 μm

รูปที่ 3.8 แสดงภาพถ่ายลวดลายของ BSG แบบลายเส้นและลายจุด กำหนด Aperture ratio เท่ากับ 15% โดยประทับลายบนแผ่นฐาน p-Si ในขนาด 100-1000 μm และแสดงรายละเอียดความ คลาดเคลื่อนจากแบบได้ในตารางที่ 3.1 จากข้อมูลการวัดขนาดลวดลายด้วยกล้อง Microscope กำลังขยาย 10 เท่า ซึ่งทำการวัดทั้งหมด 5 ครั้งและนำมาเฉลี่ย พบว่าขนาดลวดลายที่ได้จากการประทับ ลายมีขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดลวดลายที่ออกแบบไว้ โดยมีขนาดแตกต่างกันไม่เกิน 2.5% ในลวดลายจุด ไม่สามารถได้ลวดลายในขนาด 100 μm ได้จากข้อจัดของสมบัติไวแสง และขนาดรูพรุนของแผ่น Foam พอริเมอร์ที่ใช้

	ลวดลายจากเ	าารออกแบบ	ลวดลายจากการประทับลาย			
ลวดลาย	ขนาดลวดลาย	ระยะห่าง	ขน <mark>าดลวดล</mark> าย	Exec. (0()	ระยะห่างเฉลี่ย	Euro (0()
	(µm)	(µm)	เฉลี่ย (µm)	Error (%)	(µm)	EffOr (%)
	100	660	101.38	1.4%	674.67	2.2%
แบบเส้น	250	1650	251.58	0.6%	1664.72	0.9%
	500	3300	493.16	-1.4%	3303.14	0.1%
แบบจุด	250	575	261.20	4.5%	560.74	-2.5%
	500	1150	506.54	1.3%	1151.54	0.1%
	1000	2300	1000.60	0.1%	2286.79	-0.6%

ตารางที่ 3.1 ผลการประทับลาย BSG แบบลายเส้นและลายจุดเปรียบเทียบกับลวดลายที่ออกแบบใน เงื่อนไขขนาดลวดลาย

รูปที่ 3.9 (ก)-(ง) แสดงลวดลายของ BSG ลงบนแผ่นฐาน p-Si ที่มีเงื่อนไข Aperture ratio ที่ 20% 15% 10% และ 5% ตามลำดับ จากผลในตารางที่ 3.2 พบว่าขนาดลวดลายที่ได้มีขนาดที่ใกล้เคียงกับ ขนาดลวดลายที่ออกแบบไว้ โดยมีขนาดแตกต่างกันไม่เกิน 3.6% ดังนั้นวิธีการประทับลายสาร BSG สำหรับ การแพร่ในบางบริเวณจึงสามารถนำวิธีการประทับลายซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ำ สามารถประทับลาย ได้หลายครั้ง ไม่ใช้ปริมาณสารละลายมากเนื่องจากประทับลายในบริเวณที่ต้องการได้โดยตรง

(ข)

รูปที่ 3.9 ลวดลาย BSG บนแผ่นฐาน p-SI ด้วยการประทับลายมีขนาด 250 µm และ Aperture ratio ที่ (ก) 20% (ข) 15% (ค) 10% และ (ง) 5%

ตารางที่ 3.2 ผลการประทับลาย BSG แบบลายเส้นเปรียบเทียบกับลวดลายที่ออกแบบในเงื่อนไข Aperture ratio

Aperture	ลวดลายจากเ	การออกแบบ	<mark>ลวดลาย</mark> จากการประทับลาย			
ratio (%)	ขนาดลวดลาย (µm)	ระยะห่าง (µm)	ขนาด <mark>ลวดลาย</mark> เฉลี่ย (µm)	Error (%)	ระยะห่างเฉลี่ย (µm)	Error (%)
20		1250	254.09	1.6%	1252.92	0.2%
15	250	1650	251.58	0.6%	1664.72	0.9%
10	230	2500	256.59	2.6%	2458.26	-1.7%
5		5000	259.09	3.6%	4940.31	-1.2%

เมื่อนำลายประทับของ BSG ที่เป็นสารละลายประกอบโบรอน มีค่าเปอร์เซ็นต์อะตอมโบรอน ประมาณ 0.15% ไปผ่านกระบวนการแพร่ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1150℃ เป็นเวลา 30 นาที ภายใต้ บรรยากาศไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่มีอัตราการไหลเท่ากับ 100 sccm และนำไปวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแผ่น พบว่าเกิดบริเวณ p⁺⁺ Si มีค่า ho_{sheet} เท่ากับ 68.89 Ohm/sheet มีค่าต่ำกว่า ho_{sheet} ของแผ่นฐานใน บริเวณที่ไม่มีการประทับลาย BSG ซึ่งบริเวณแผ่นฐาน Si มีค่าประมาณ 107.86 Ohm/sheet ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการประทับลายสารละลายโบรอนสามารถสร้างชั้น LBSF ได้ โดยมี ho_{sheet} มีค่าแตกต่างกันใน 2 บริเวณอย่างเห็นได้ชัด

3.2.3 การเปิดช่องไดอิเล็กทริกด้วย Foam stamp

ในขั้นตอนหลังจากการแพร่สารเจือโบรอนที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้อะตอมสารเจือโบรอนแพร่ใน บริเวณที่ประทับลาย BSG แล้วได้ทำการสร้างขั้นซิลิกอนไนไตรด์ (SiN_x) ด้วยเทคนิค PECVD ที่อุณหภูมิ 450°C และความดัน 1500 mTorr โดยใช้ส่วนผสมของก๊าซไซเลน (SiH₄) และแอมโมเนีย (NH₃) สำหรับทำ ปฏิกิริยา ชั้น SiN_x นี้สร้างขึ้นที่บริษัทโซลาร์ตรอนจำกัด (มหาชน) หลังจากนั้นเปิดช่องชั้นซิลิกอนไนไตรด์ที่ ด้านหลัง เพื่อให้ขั้วโลหะไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับบริเวณ p⁺⁺ การสกัดช่องเปิดได้ใช้วิธีการประทับลายด้วย กรดไฮโดรฟลูออริก (Hydrofluoric acid) เข้มข้น 25% เป็นเวลา 1 นาที ตามลวดลายของบริเวณ p⁺⁺ หลังจากนั้นนำชิ้นงานไปล้างน้ำ DI และเป่าให้แห้ง

ร**ูปที่ 3.10** ลวดลายการเปิดช่องชั้นฟิล์ม SiN_x ด้วยการประทับลายแบบที่ขนาด 250 µm ในเงื่อนไข Aperture ratio ที่ **(ก)** 20% **(ข)** 15% **(ค)** 10% และ **(ง)** 5%

รูปที่ 3.10 (ก)-(ง) แสดงลวดลายช่องเปิด SiN_x ที่ออกแบบให้ขนาดเท่ากับ 250 µm ในเงื่อนไข Aperture ratio เท่ากับ 20% 15% 10% และ 5% ตามลำดับ จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วิธีการ ประทับลายสารละลาย HF สามารถเปิดช่อง SiN_x ได้ อย่างไรก็ตามการประทับกรดที่เป็นสารสกัดฟิล์มบาง จะได้ความแม่นยำของลวดลายต่ำกว่าวิธีการประทับสารไวแสง หรือ BSG ลงบนแผ่นฐาน Si

3.3 สรุป

จากผลการทดสอบสร้างลวดลายด้วยการใช้ Foam stamp พบว่าไม่เพียงแต่การนำสารละลายต่าง ๆ ที่ต้องการประทับให้เกิดลวดลาย เพื่อใช้เป็นฟิล์มบางได้โดยตรง หรือประทับสารไวแสงเพื่อเป็นหน้ากาก ป้องกันการสกัดผิวขึ้นงาน ในงานประยุกต์ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง SE อีกทางหนึ่งเมื่อประทับ สารละลายสารเจือ ยังสามารถผลิตเป็นบริเวณ n⁺⁺ region หรือ p⁺⁺ ได้ในเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF วิธีการประทับลายจึงเป็นวิธีทางเลือกต้นทุนต่ำสำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรม ได้ อย่างไรก็ตามวิธีการประทับลายมีข้อจำกัดเรื่องขนาดของลวดลายไม่ต่ำกว่า 100 μm เนื่องจากสมบัติ เฉพาะของวัสดุ Foam พอริเมอร์ไวแสง และความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 μmของฟิล์มที่ต้องการประทับลาย ซึ่งมีความหนามากกว่าวิธีการเคลือบด้วยแรงหมุนเหวี่ยง

บทที่ 4 เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนต้นแบบด้วยวิธีการประทับลาย

4.1 บทนำ

จากข้อมูลการศึกษลักษณะของลวดลายฟิล์ม BSG หรือศึกษาลวดลายของช่องเปิดไดอิเล็กทริก ทำ ให้เรารู้ถึงข้อจำกัดการผลิต ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และเพื่อเข้าการผลิต เซลล์ชนิดใหม่ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งได้กล่าวถึงการวัดค่าความหนาและสมบัติ การหักเหแสง รวมถึงการวัดค่า life time ของพาหะในโครงสร้างการเปิดช่องไดอิเล็กทริกด้านหลังด้วยการ ประทับลาย เพื่อนำผลไปวิเคราะห์หาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีคุณภาพ

เมื่อได้เงื่อนไขช่องเปิดที่เหมาะสมแล้ว งานวิจัยในบทนี้จะได้ทดสอบการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ซิลิคอนต้นแบบโครงสร้าง Local back surface field (LBSF) ที่ประกอบด้วยชั้นไดอิเล็กทริกแบบ Local back passivation เพื่อเป็นแนวทางการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนในวิธีการที่ใช้เทคนิคการประทับลาย ให้เกิดบางบริเวณของ p⁺⁺ ที่ด้านหลังเซลล์ และทดสอบวัดประสิทธิภาพเซลล์ รวมถึงได้ทำการเปรียบเทียบ ผลผลิตกำลังไฟฟ้าของเซลล์ชนิดใหม่ต้นทุนต่ำในเชิงเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบกับเซลล์ที่ผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

4.2 กระบวนการผลิตแผ่นเซลล์<mark>แสง</mark>อาทิต<mark>ย์ผลึกซิลิคอนเชิง</mark>พาณิชย์

การผลิตเซลล์แสงอาทิ<mark>ตย์ผ</mark>ลึกซิ<mark>ลิคอนมีขั้นตอนการผลิต</mark>หลัก ๆ ดังนี้

 กระบวนการสร้างผิวขรุขระ (Texturing process) ให้กับแผ่นผลึกซิลิคอนด้วยสารละลายเคมี แสดงในรูปที่ 4.1 เพื่อลดการสะท้อนแสงกลับที่ผิวได้ถึง 20%

รูปที่ 4.1 การสกัดผิวผลึกซิลิคอนด้วยสารละลายเคมี และผิวขรุขระกับการลดลงของแสงสะท้อน

2. กระบวนการแพร่สารเจือฟอสฟอรัสที่อุณหภูมิสูง (Diffusion process) เพื่อสร้างชั้น n-emitter ด้านบนแผ่นผลึกซิลิคอน จะได้รูปแบบรอยต่อ p/n แสดงในรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.2 การแพร่สารเจือในเตาอุณหภูมิสูง

 กระบวนการกำจัดบริเวณที่ฟอสฟอรัสแพร่ในบริเวณขอบแผ่นที่ไม่ต้องการ (Edge isolation) และบริเวณที่ฟอสฟอรัสแพร่ตกค้างที่เรียกว่าชั้น Phosphorus silicate glass (PSG) ด้วยแช่แผ่นให้ผิว ด้านข้างสัมผัสกับสารละลายเคมี แสดงในรูปที่ 4.3

รูปที่ 4.3 ก<mark>ารส</mark>กัดผิวที่ขอบแผ่นเพื่อกำจัดบริเวณที่ฟอสฟอรัสแพร่ซึม

 กระบวนการเคลือบชั้นป้องการการสะท้อนแสง (Anti-reflective coating) ด้วยชั้น SiN_x จาก ระบบ PECVD (Pressure enhanced chemical vapor deposition) บนชั้น n-emitter เพื่อเพิ่มการ ดูดกลืนแสงให้ดีขึ้น และลดจุดบกพร่อมที่ผิวสัมผัสของ n-emitter

รูปที่ 4.4 การสร้างชั้น SiN_x ในระบบเตา PECVD

5. กระบวนการพิมพ์ลายขั้วไฟฟ้า (Screen printing process) ด้านหน้าและด้านหลังด้วยโลหะ สำหรับขั้วลบ และขั้วบวก แสดงในรูปที่ 4.5

รูปที่ 4.5 การพิมพ์ลายขั้วไฟฟ้า

6. กระบวนการ Fast firing ขั้วไฟฟ้าทั้งสองด้าน เกิดโลหะแพร่ซึม เพื่อให้มีคุณสมบติทางไฟฟ้า ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ดี แสดงในรูปที่ 4.6

รูปที่ 4.6 กระบวนการ Fast firing ให้กับโลหะขั้วไฟฟ้า

7. กระบวนการวัด ทดสอบทุกเซลล์ และคัดเลือกจัดตามพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า แสดงในรูปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 กระบวนการทดสอบและคัดเลือกเซลล์ตามค่าประสิทธิภาพ

รูปที่ 4.8 แสดงเปรียบเทียบกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ต้นทุนต่ำด้วยวิธี ประทับลาย (Stamping) กับกระบวนการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์ พบว่ามีการเพิ่มกระบวนการผลิตของการ สร้างลวดลายฟิล์มสารเจือโบรอนด้วยวิธี Stamping และการเปิดช่อง SiN_x ตามลวดลายของ p⁺⁺ LBSF ด้วย Chemical etching จากวิธี Stamping ขณะที่กระบวนการแพร่สารเจือด้วยความร้อนใช้วิธีการผลิต เดิมแต่อาจปรับเงื่อนไขของอุณหภูมิและความดันในเตาให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดการแพร่ของ ฟอสฟอรัสที่ด้านบนพร้อมกับการแพร่ของโบรอนที่ด้านหลังตามลวดลายที่สร้างขึ้น

กระบวนการผลิตเซลล์ทั่วไปในเชิงพาณิชย์ กระบวนการผลิตเซลล์ LBSF ด้วยวิธี Stamping

ร**ูปที่ 4.8** เปรียบเทียบกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ต้นทุนต่ำด้วยวิธีประทับลาย (Stamping) กับกระบวนการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์

4.3 เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนต้นแบบ LBSF ด้วยวิธีการประทับลาย

4.3.1 การผลิตเซลล์ที่มีบริเวณ p⁺⁺ Si ในแบบลวดลายเส้น และลายจุด ด้วยวิธีการประทับลาย

โครงสร้างของเซลล์ในรูปที่ 4.9 มีขั้นตอนการเตรียมดังนี้

แผ่นผลึกโพลีซิลิคอนชนิด p-type ขนาด 3x3 cm² มีความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะระหว่าง 1 3 โอห์มเซนติเมตร ความหนา 200 μm นำมากำจัดชั้นออกไซด์ (Native oxide) ด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก
 (Hydrofluoric acid) เข้มข้น 5% เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวด้วยวิธี RCA

ร**ูปที่ 4.9** ภาพตัดขวางของโคร<mark>งสร้</mark>างเซลล์ที่<mark>มีบริ</mark>เวณ p⁺⁺ Si ในแบบลวดลายเส้น

2. สร้างบริเวณ p⁺⁺ Si ด้านหลังเซลล์ด้วยวิธีประทับลายสารละลายประกอบโบรอนที่มี เปอร์เซ็นต์อะตอมของโบรอนในสารเจือเป็น 0.15% ที่ด้านหลังของแผ่นฐานซิลิกอน โดยมีพื้นที่ลายประทับ ลวดลายเส้นขนาด 250 µm ในเงื่อนไขค่า Aperture ratio เท่ากับ 100% (ไม่มีช่องเปิด) 50% 20% 15% 10% และ 5% ทำการอบแห้งที่อุณหภูมิ 200 °C จากนั้นผ่านกระบวรการแพร่สารเจือที่อุณหภูมิ 1150°C เป็นเวลา 30 นาที ภายใต้บรรยากาศในโตรเจนบริสุทธิ์ที่มีอัตราการไหลเท่ากับ 100 sccm ด้วยเตาเผา อุณหภูมิสูง ภายหลังจากการแพร่สารที่อุณหภูมิสูงจะเกิดชั้นแก้วโบโรซิลิเกต (Borosilicate glass) จาก ปฏิกิริยาระหว่างโบรอนและแผ่นฐาน Si ขึ้น ซึ่งสามารถล้างด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก (Hydrofluoric acid) เข้มข้น 10% เป็นเวลา 5 นาที

3. สร้างชั้น n-Si ด้วยวิธีการเคลือบสารละลายประกอบฟอสฟอรัสที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ ฟอสฟอรัสประมาณ 0.43% ที่ด้านหน้าของแผ่นฐานซิลิกอน ด้วยการหมุนเหวิ่ง (Spin coating) ทำการ อบแห้งที่อุณหภูมิ 200 °C จากนั้นทำการแพร่สารเจือที่อุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลา 60 นาที ภายใต้ บรรยากาศไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่มีอัตราการไหลเท่ากับ 100 sccm ด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง การแพร่สารเจือที่ อุณหภูมิสูงทำให้เกิดชั้นแก้วฟอสโฟซิลิเกต (Phosphosilicate glass) ซึ่งสามารถล้างด้วยกรดไฮโดรฟลูออ ริก (Hydrofluoric acid) เข้มข้น 5% เป็นเวลา 5 นาที

 สร้างชั้นไดอิเล็กทริกทั้งด้านบนและด้านหลังเซลล์ เพื่อป้องกันผลของการรวมตัวใหม่ที่ผิว (Surface recombination) ของพาหะที่บริเวณผิวซิลิคอน ดังนั้นจึงสร้างชั้นซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) ด้วย วิธี Dry oxidation ที่อุณหภูมิ 900°C เป็นเวลา 120 นาที ภายใต้บรรยากาศออกซิเจนบริสุทธิ์ที่มีอัตราการ ไหลเท่ากับ 400 sccm ด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง ส่วนการสร้างชั้นซิลิกอนไนไตรด์ (SiN_x) ได้ใช้เทคนิค PECVD ที่อุณหภูมิ 450°C ที่ความดัน 1500 mTorr ในปฏิกิริยาของก๊าซไซเลน (SiH₄) และแอมโมเนีย (NH₃)นิยามของโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ในเงื่อนไขต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 4.1

Sample names	PV structures
1. NP _SiO ₂	รอยต่อ SiO ₂ /n-Si/p-Si substrate/SiO ₂
2. NP(P ⁺ _Full100%)_SiO ₂	รอยต่อ SiO ₂ / n-Si/p-Si substrate /p ⁺⁺ ทั่วแผ่น/SiO ₂
3. NP(P ⁺ _Line A µm B %)_SiO ₂	รอยต่อ SiO ₂ / n-Si/p-Si substrate /p ⁺⁺ ลายเส้นกว้าง A µm ที่
	Aperture ra <mark>tio</mark> B %/ SiO ₂
4. NP_SiN _x	รอยต่อ SiN _x /n-Si/p-Si substrate/SiN _x
5. NP(P ⁺ _Full 100%)_SiN _x	รอยต่อ Si <mark>N_x/ n-Si</mark> /p-Si substrate /p ⁺⁺ ทั่วแผ่น/SiN _x
6. NP(P ⁺ _Line A µm B %)_SiN _x	รอยต่อ S <mark>iN,/ n-Si</mark> /p-Si substrate /p ⁺⁺ ลายเส้นกว้าง A µm ที่
	Aperture ratio B%/ SiN _x
7. NP(P ⁺ _Dot A µm B %)_SiN _x	รอยต่ <mark>อ S</mark> iN _x / n-Si <mark>/p-</mark> Si substrate /p ⁺⁺ ลายจุดกว้าง A µm ที่
	Aperture ratio <i>B</i> %/ SiN _x

ตารางที่ 4.1 นิยามของเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบในโครงสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ

4.3.2 การวัดคุณสมบัติทางแสงและวัดค่า life-time

โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนประสิทธิภาพสูงจะประกอบด้วยชั้นไดอิเล็กทริกบางทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ดังนั้นในบทนี้จึงศึกษาวัดความหนาและค่าดัชนีหักเหแสงของชั้นฟิล์มบาง SiO₂ และ SiN_x ด้วยเทคนิค Ellipsometry รุ่น SE 400advanced จากบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ดังแสดงในรูป ที่ 4.10 โครงสร้างของชิ้นงานแสดงในรูปที่ 4.9

การวัดค่าช่วงชีวิตพาหะใช้เครื่อง Photoconductance lifetime tester ยี่ห้อ Sinton instrument รุ่น WCT-120 แสดงภาพถ่ายในรูปที่ 4.11 โดยใช้เทคนิค Quasi-steady-state photoconductance (QSSPC) ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดย ใช้ค่าพารามิเตอร์ความหนาแน่นของพาหะข้างน้อย (Minority carrier density) เท่ากับ 1x10¹⁵ cm⁻³ ค่า ช่วงชีวิตพาหะของเซลล์ที่สูงนั้นสามารถแสดงถึงความน่าจะเป็นสูงในการรวบรวมพาหะที่ขั้วไฟฟ้า ทำให้ เกิดกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่าสูงด้วยเช่นกัน

ค่า Lifetime สุทธิของเนื้อวัสดุ ($au_{ ext{Bulk}}$) ประกอบด้วย Lifetime ชนิดต่าง ๆ กันตามลักษณะที่ แตกต่างกันของกระบวนการรวมตัวใหม่ทั้ง 3 ชนิด ดังนั้น $au_{ ext{Bulk}}$ สามารถแสดงในสมการที่ (4.1)

$$\frac{1}{\tau_{Bulk}} = \frac{1}{\tau_{Band}} + \frac{1}{\tau_{SHR}} + \frac{1}{\tau_{Auger}}$$
(4.1)

โดยที่ au_{Band} คือLifetime ของพาหะข้างน้อยที่ก่อนเกิด Band-band recombination au_{SHR} คือlifetime ของพาหะข้างน้อยที่ก่อนเกิด Recombination through traps au_{Auger} คือlifetime ของพาหะข้างน้อยที่ก่อนเกิด Auger recombination

Auger lifetime อยู่ในฟังก์ชันความหนาแน่นของพาหะแสดงได้ในสมการที่ (4.2) ซึ่ง Lifetime จากกระบวนการ Auger จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่นในกรณีที่ ระดับความเข้มข้นของสารเจือสูงขึ้นแสดงในรูปที่ 2.8 [จากหนังสือ Solar Cells, M.A. Green,1992]

$$\tau_{Auger} = \frac{1}{CN_A^2} \tag{4.2}$$

โดยที่ C คือค่าประสิทธิ์ของ Auger สำหรับวัส<mark>ดุชิ</mark>ลิคอนให้มีค่าเท่ากับ 1.66×10⁻³⁰cm⁶/s

รูปที่ 4.10 Ellipsometer รุ่น SE 400advanced สำหรับวัดความหนาและค่าดัชนีหักเหแสงของชั้นฟิล์ม บางไดอิเล็กทริก

รูปที่ 4.11 เครื่องวัดค่าช่วงชีวิตของพาหะ Sinton รุ่น WCT-120 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) (http://www.sintoninstruments.com)

4.3.3 ผลการวัดค่าดัชนีหักเหแสงและความหนาของฟิล์มไดอิเล็กทริกบนเซลล์

การวัดความหนาและค่าดัชนีหักเหแสงของชั้นฟิล์มทั้งหมด 5 ครั้งและนำมาเฉลี่ย พบว่าค่าความ หนาและค่าดัชนีหักเหแสงของฟิล์มที่เกิดขึ้นด้านหน้า และด้านหลังเซลล์มีค่าใกล้เคียงกัน มีความหนาเฉลี่ย ของ SiO₂ มีค่าประมาณ 74 nm และมีค่าดัชนีหักเหแสงประมาณ 1.66 ส่วนชั้นฟิล์ม SiN_x มีความหนา เฉลี่ยประมาณ 97 nm และมีค่าดัชนีหักเหแสงประมาณ 2.10 โครงสร้างเซลล์ที่วัด life-time ได้ทำประทับ ลายของ BSG ด้วยเครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติ กำหนดลวดลายขนาด 250 μm ในเงื่อนไข Aperture ratio ค่าต่าง ๆ ผลการวัดค่าต่าง ๆ ทั้งฟิล์มด้านหน้าและด้านหลังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.2

	Front side		Rear side	
Samples	Thickness	Refractive	Thickness	Refractive
	(nm)	index	(nm)	index
NP_SiO ₂	76.97	1.69	73.97	1.68
NP(P ⁺ _Full100%)_SiO ₂	72.58	1.68	72.55	1.66
N/P(P ⁺ _ Line3000µm 50%)_SiO ₂	77.41	1.64	72.03	1.66
NP(P ⁺ _ Line250µm 20%)_SiO ₂	80.02	1.64	78.12	1.61
NP(P ⁺ _ Line250µm 15%)_SiO ₂	78.33	1.65	77.30	1.63
NP(P ⁺ _ Line250µm 10%)_SiO ₂	75.15	1.66	73.41	1.67
NP(P ⁺ _ Line250µm 5%)_SiO ₂	65.54	1.74	72.13	1.66
NP_SiN _x	82.36	2.12	98.36	2.08
NP(P ⁺ _Full 100%)_SiN _x	106.54	2.01	101.99	2.18
NP(P ⁺ _ Line3000µm 50%)_SiN _×	100.97	2.04	96.70	2.20
NP(P ⁺ _ Line250µm 20%)_SiN _x	89.85	2.09	94.29	2.13
NP(P ⁺ _ Line250µm 15%)_SiN _x	96.43	2.06	99.45	2.15
NP(P ⁺ _ Line250µm 10%)_SiN _x	88.33	2.08	96.89	2.12
NP(P ⁺ _ Line250µm 5%)_SiN _x 101.59		2.05	94.96	2.13

ตารางที่ 4.2 ค่าความหนาและค่าดัชนีหักเหแสงของชั้นฟิล์มบางไดอิเล็กทริก

4.3.4 ผลการวัดค่า life-timeของฟิล์มไดอิเล็กทริกบนเซลล์

ผลที่วัดได้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.3 โดยที่ J_o คือค่ากระแสมืด และ V_{oc} คือค่าแรงดันไฟฟ้า เปิดวงจรที่ได้จากโปรแกรมการจำลองผล เนื่องจากเซลล์ที่นำไปวัดนั้นไม่มีขั้วไฟฟ้าโลหะทั้งด้านบนและ ด้านหลังเซลล์ และเมื่อวัดค่า Life time ได้เราสามารถนำไปคำนวณหาค่าความเร็วในการรวมตัวใหม่ของ พาหะได้ในโครงสร้างชั้นฟิล์มไดอิเล็กทริก 2 ด้านบนรอยต่อ n/p ที่ไม่มีบริเวณ p⁺⁺ พบว่าฟิล์ม SiN_x ให้ค่า Life time สูงกว่า SiO₂ ประมาณ 2 เท่า เมื่อเซลล์มีบริเวณ p⁺⁺ ทั่วแผ่น ผลของค่า Life time น้อยที่สุด เป็นผลมาจากการรวมตัวใหม่ของพาหะในแบบ Auger recombination ที่มีบริเวณการแพร่สารเจือสูงจึง เกิดอัตราการรวมตัวใหม่ของพาหะที่สูงขึ้น ทำให้ค่า Life time ที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าทุกกลุ่ม

	Lifatima	Surface		1sun
Samples		recombination	J _O (A/cm ²)	implied
	(μs)	velocity (cm/s)		V_{oc} (V)
NP_SiO ₂	11.90	1681	1.2E-12	0.613
NP(P ⁺ _Full100%)_SiO ₂	7.38	2710	5.2E-12	0.603
NP(P ⁺ _ Line3000µm 50%)_SiO ₂	14.99	1334	6.4E-13	0.613
NP(P ⁺ _ Line250µm 20%)_SiO ₂	21.71	921	1.1E-12	0.621
NP(P ⁺ _ Line250µm 15%)_SiO ₂	22.64	883	1.9E-12	0.627
NP(P ⁺ _ Line250µm 10%)_SiO ₂	18.65	1072	1.4E-12	0.62
NP(P ⁺ _ Line250µm 5%)_SiO ₂	11.60	1724	1.9E-12	0.62
NP_SiN _x	23.98	834	2.8E-12	0.634
NP(P ⁺ _Full 100%)_SiN _x	12.51	1599	5.8E-13	0.608
NP(P ⁺ _ Line3000µm 50%)_SiN _x	16.78	1192	2E-12	0.624
NP(P ⁺ _ Line250µm 20%)_SiN _x	21.46	932	6.2E-13	0.625
NP(P ⁺ _Line250µm 15%)_SiN _x	26.69	749	9.7E-13	0.628
NP(P ⁺ _ Line250µm 10%)_SiN _x	22.42	892	1.1E-12	0.627
NP(P ⁺ _ Line250µm 5%)_SiN _x	14.70	1361	1.8E-12	0.623

ตารางที่ 4.3 ค่าช่วงชีวิตของพาหะ และค่าอัตราความเร็วในการรวมตัวใหม่ของพาหะ ค่ากระแสไฟฟ้ามืด และแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจร

กลุ่มเซลล์ที่มีลวดลายเส้นของ p⁺⁺ ทั้ง SiO₂ และ SiN_x ที่ค่า Aperture ratio ต่าง ๆ กันนั้นพบผล ของค่า Life time ที่วัดได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผลของการมีชั้นฉนวนเป็นชั้นพาสซิเวชัน (Passivation) ลดผลจุดบกพร่อง (Defects) และค่า Life time สูงสุดที่เซลล์ในเงื่อนไขลวดลายเส้นของ

รูปที่ 4.12 ความสัมพันธ์ของค่าช่วงชีวิตข<mark>อง</mark>พาหะ แล<mark>ะอัต</mark>ราความเร็วในการรวมตัวใหม่ของพาหะ ของ เซลล์ในเงื่อนไขช่องเปิดขนาดต่าง ๆ

ร**ูปที่ 4.13** ความสัมพันธ์ของค่ากรแสมืด และแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรที่ได้จากการวัด Life time

p⁺⁺ ขนาด 250µm ที่มีค่า Aperture ratio 15% สำหรับชิ้นงาน NP(P⁺_ Line250µm 15%)_SiN_x ให้ค่า 26.69 µs และสำหรับชิ้นงาน NP(P⁺_ Line250µm 15%)_SiO₂ ให้ค่า 22.64 µs จากผลการวัด Life time เมื่อนำไปคำนวณหาค่าอัตราความเร็วของการวมตัวใหม่ของพาหะนั้นมีค่าน้อยที่สุด ค่าทั้งสอง สามารถสรุปผลความสัมพันธ์ได้ในกราฟรูปที่ 4.12 จากผลแสดงให้เห็นถึงค่า Life time ที่มีค่าสูงมี ความสัมพันธ์กับค่ากระแสมืดที่มีค่าน้อยด้วย แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสมืดและแรงดันไฟฟ้า เปิดวงจรในรูปที่ 4.13

เมื่อเทียบผลการวิจัยครั้งนี้ที่ศึกษาการแพร่สารเจือที่ลวดลายของ BSG ในเงื่อนไขค่า Aperture ratio เหมาะสมที่สุดที่ค่าประมาณ 15% นั้นมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยครั้งก่อนที่คณะวิจัยได้ศึกษา การเปิดช่องชั้น SiO₂ ด้วยวิธี inkjet printing และอาศัยการแพร่ของอะตอม Al จากขั้วไฟฟ้าด้านหลัง แพร่ซึมที่อุณหภูมิ Eutectic ระหว่าง Al-Si กระทั้งเกิดเป็นอัลลอยของอะลูมิเนียมออกไซด์ และ p⁺⁺ในช่อง เปิดดังกล่าว ซึ่งค่าประสิทธิภาพเซลล์เพิ่มขึ้นจากเซลล์โครงสร้างในอุตสาหกรรม (Δ%η) ประมาณ 2% ที่มี ค่า Aperture ratio ประมาณ 15% ดังนั้นจึงสามารถยืนยันว่าการสร้างลอดลายของบริเวณ p⁺⁺ ที่ด้านหลัง เซลล์ด้วยวิธีต้นทุนต่ำ สามารถพัฒนาต่อยอ<mark>ดเพื่</mark>อนำเข้าสู่การผลิตในอุตสาหกรรมได้

4.4 เซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนต้น<mark>แบ</mark>บด้วยการประทับ<mark>ลา</mark>ย

ในงานวิจัยนี้ได้นำเงื่อนไข Aperture ratio เหมาะสมที่สุดที่ค่าประมาณ 15% ร่วมกับชั้นไดอิเล็ก ทริกชนิด SiN_x มาผลิตเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนต้นแบบด้วยการประทับลาย ซึ่งมีการแพร่ สารเจือโบรอนความเข้มข้นสูง (p⁺⁺ Si) บางบริเวณด้านหลังเซลล์ และทำการเปิดช่องชั้นออกไซด์เพื่อให้เกิด โครงสร้าง Passivated emitter and rear locally diffused cell (PERL) หรือ Local back passivation หรือ Local back surface field (LBSF) ที่ด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีโครงสร้างแสดงดังรูปที่ 4.14

รูปที่ 4.14 โครงสร้างเซลล์แบบ Local back surface field (LBSF) ที่ทำการศึกษา

การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนต้นแบบด้วยวิธีการประทับลายมีขั้นตอนดังนี้

แผ่นผลึกโพลีซิลิคอนชนิด p-type ขนาด 3x3 cm² มีความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะระหว่าง 1-3
 โอห์มเซนติเมตร ความหนา 200 µm นำมากำจัดชั้นออกไซด์ (Native oxide) ด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก
 (Hydrofluoric acid) เข้มข้น 5% เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวด้วยวิธี RCA

2. สร้างบริเวณ p⁺⁺ Si ด้านหลังเซลล์ด้วยวิธีประทับลายสารละลายประกอบโบรอนที่มีเปอร์เซ็นต์ อะตอมของโบรอนในสารเจือเป็น 0.15% ที่ด้านหลังของแผ่นฐานซิลิกอน โดยมีพื้นที่ลายประทับลวด ลายเส้นขนาด 250 µm ในเงื่อนไขค่า Aperture ratio เท่ากับ 100% (ไม่มีช่องเปิด) 50% 20% 15% 10% และ 5% ทำการอบแห้งที่อุณหภูมิ 200 ℃ จากนั้นผ่านกระบวรการแพร่สารเจือที่อุณหภูมิ 1150℃ เป็นเวลา 30 นาที ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่มีอัตราการไหลเท่ากับ 100 sccm ด้วยเตาเผา อุณหภูมิสูง ภายหลังจากการแพร่สารที่อุณหภูมิสูงจะเกิดชั้นแก้วโบโรซิลิเกต (Borosilicate glass) จาก ปฏิกิริยาระหว่างโบรอนและแผ่นฐาน Si ขึ้น ซึ่งสามารถล้างด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก (Hydrofluoric acid) เข้มข้น 10% เป็นเวลา 5 นาที

3. สร้างชั้น n-Si ด้วยวิธีการเคลือบสารละลายประกอบฟอสฟอรัสที่มีเปอร์เซ็นต์อะตอมของ ฟอสฟอรัสประมาณ 0.43% ที่ด้านหน้าของแผ่นฐานซิลิกอน ด้วยการหมุนเหวิ่ง (Spin coating) ทำการ อบแห้งที่อุณหภูมิ 200 °C จากนั้นทำการแพร่สารเจือที่อุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลา 60 นาที ภายใต้ บรรยากาศไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่มีอัตราการไหลเท่ากับ 100 sccm ด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง การแพร่สารเจือที่ อุณหภูมิสูงทำให้เกิดชั้นแก้วฟอสโฟซิลิเกต (Phosphosilicate glass) ซึ่งสามารถล้างด้วยกรดไฮโดรฟลูออ ริก (Hydrofluoric acid) เข้มข้น 5% เป็นเวลา 5 นาที

 สร้างชั้น SiN_x ทั้งด้านบนและด้านหลังเซลล์ เพื่อป้องกันผลของการรวมตัวใหม่ที่ผิว (Surface recombination) ของพาหะที่บริเวณผิวซิลิคอน ด้วยเทคนิค PECVD ที่อุณหภูมิ 450℃ ที่ความดัน 1500 mTorr ในปฏิกิริยาของก๊าซไซเลน (SiH₄) และแอมโมเนีย (NH₃) ความหนาฟิล์มเฉลี่ยประมาณ 97 nm

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 4.15 ลวดลายการเปิดช่องชั้นฟิล์ม SiN_x ด้านหลังเซลล์ด้วยวิธีการประทับลายที่มี Aperture ratio ประมาณ15% และขนาดลายเส้นเปิดเท่ากับ **(ก)** 100 μm **(ข)** 250 μm และ **(ค)** 500 μm 5. เปิดช่องชั้น SiN_x ที่ด้านหลัง เพื่อให้ขั้วโลหะไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับบริเวณ p⁺ ด้วยวิธีการประทับ ลายด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก (Hydrofluoric acid) เข้มข้น 25% เป็นเวลา 1 นาที ให้ตรงตำแหน่งลวดลาย ของบริเวณ p⁺⁺ ที่ได้จากการแพร่สารละลายโบรอนในขั้นตอนที่ 2 ภาพถ่ายตัวอย่างของช่องเปิด SiN_x ด้วย เทคนิคการประทับลายแสดงในรูปที่ 4.15

6. สร้างขั้วไฟฟ้าให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบ ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าด้านบนลวดลายก้างปลาจาก การพิมพ์ลายของ Silver paste ทำการอบแห้งที่อุณหภูมิ 200 ℃ จากนั้นพิมพ์ลายขั้วโลหะไฟฟ้าด้านล่าง ทั่วบริเวณด้วย Aluminum paste ทำการอบแห้งที่อุณหภูมิ 200 ℃ และผ่านกระบวนการ Fast firing ที่ ห้องโซน 1 2 3 และ 4 ที่อุณหภูมิประมาณ 300℃ 500℃ 890℃ และ 100℃ โดยห้องโซน 1-3 แช่ไฟ ใน แต่ละห้องนาน 10 วินาที ซึ่งเป็นระบบความร้อนด้วยหลอด IR มีระบบสายพานลำเลียงชิ้นงานผ่านเข้าห้อง ความร้อนทั้งหมด 3 โซน ออกแบบขึ้นใช้เองในห้องปฏิบัติการ พิกัดอุณหภูมิสูงสุดที่ 890℃ แสดงภาพถ่าย ของเครื่อง Fast firing ที่สร้างขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ F5105 ในรูปที่ 4.16

รูปที่ 4.16 เครื่อง Fast firing ที่สร้างขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ F5105

7. เซลล์ต้นแบบหลังจากผ่านกระบวนการ Fast firing แล้วขั้วไฟฟ้าทั้งสองด้านจะมีสีขาวขึ้น แสดง ภาพของเซลล์ด้านบน และด้านหลังในรูปที่ 4.17

(ก)	(খ)

รูปที่ 4.17 (ก) ภาพถ่ายด้านบนของเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบ และ (ข) ด้านหลังเซลล์

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการวัดค่าทางไฟฟ้า และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์ต้นแบบที่ มีเงื่อนไขการสร้างบริเวณ LBSF ในขนาดช่องเปิดต่าง ๆ และเงื่อนไขของค่าเปอร์เซ็นต์ Aperture ratio 5-100% การศึกษานี้ได้ทำการสร้างเซลล์อ้างอิงที่มีโครงสร้างรอยต่อ Ag/n/p/Al ผ่าน Fast firing ที่พิกัด อุณหภูมิ การวัดภายใต้ 1 sun ความเข้มแสงประมาณ 100mA/cm²

Samples	V_{oc} (V)	J _{sc} (mA)	FF	η (%)	$arDelta\eta$ (%)
NP_SiN _x (Reference cell)	0.507	32.36	0.537	8.81	0
NP(P ⁺ _Full 100%)_SiN _x	0.505	29.74	0.555	8.33	-0.48
NP(P ⁺ _ Line3000µm 50%)_SiN _x	0.496	26.19	0.526	6.83	-1.98
NP(P ⁺ _ Line250µm 20%)_SiN _x	0.512	28.85	0.549	8.10	-0.71
NP(P ⁺ _ Line250µm 15%)_SiN _x	0.520	31.95	0.555	9.22	0.41
NP(P ⁺ _ Line250µm 10%)_SiN _x	0.506	2 <mark>8.96</mark>	0.550	8.06	-0.75
NP(P ⁺ _ Line250µm 5%)_SiN _x	0.503	28.4	0.574	8.19	-0.62
NP(P ⁺ _ Line100µm 15%)_SiN _x	0.525	33.39	0.557	9.77	0.96
NP(P ⁺ _ Line250µm 15%)_SiN _x	0.515	35.49	0.525	9.59	0.78
NP(P ⁺ _ Line500µm 15%)_SiN _x	0.527	34.26	0.569	10.27	1.46
575			J.		
NP(P ⁺ _ Dot250µm 15%)_SiN _x &	0.512	34.95	0.503	9.00	0.19
NP(P ⁺ _ Dot500µm 15%)_SiN _x	0.528	34.98	0.550	10.16	1.35
NP(P ⁺ _ Dot1000µm 15%)_SiN _x	0.523	34.74	0.554	10.06	1.25

ตารางที่ 4.4 ค่าทางไฟฟ้าและประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF

เมื่อทำการเปรียบเทียบกับเซลล์อ้างอิงที่มีชั้น SiN_x ทั้งสองด้าน พบว่าจากผลการวัดพบว่าเซลล์ ชนิดใหม่ LBSF ในเงื่อนไขเปิดช่องรูปแบบวงกลม และแบบลายเส้นในเงื่อนไขทุกขนาดนั้นให้ค่า ประสิทธิภาพของเซลล์เพิ่มขึ้น โดยเซลล์ที่กำหนดช่องเปิด SiN_x บนบริเวณ p⁺⁺ ขนาด 250 μm ในเงื่อนไข Aperture ratio ค่า 5-100% พบว่าเซลล์ที่มีค่า Aperture ratio ที่ 15% ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์ เงื่อนไข Aperture ratio อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลของค่า Life time มากกว่าเงื่อนไขอื่น และค่าอัตรา ความเร็วในการรวมตัวใหม่ของพาหะมีค่าน้อยสุดที่เงื่อนไขการเปิดช่อง SiN_x มี Aperture ratio 15% แสดงในตารางที่ 4.4 และเมื่อกำหนดค่า Aperture ratio ที่ 15% ในเงื่อนไขช่องเปิดชั้น SiN_x รูปแบบ วงกลมให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 0.19-1.35% และเงื่อนไขช่องเปิดลายเส้นให้ค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น Δ% η มีค่าสูงกว่าเซลล์อ้างอิงประมาณ 1.46% แสดงกราฟ J-V ของเซลล์แสงอาทิตย์ในเงื่อนไข Aperture ratio 15% ในรูปที่ 4.18 และ 4.19

ร**ูปที่ 4.19** กราฟ J-V ของเซลล์แสงอาทิตย์ LBSF ในลายจุดเปิดช่อง SiN $_{\rm x}$

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงสร้าง LBSF ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตด้วยวิธี Stamp สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานได้ อย่างไรก็ตามเซลล์ที่ผลิตขึ้นในห้องปฏิบัติการทุกเงื่อนไขมีค่า FF ต่ำกว่า เซลล์ประสิทธิภาพสูงที่ผลิตในมาตรฐานอุตสาหกรรม เนื่องจากอุปกรณ์การผลิตอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ ที่ประกอบด้วย

 ระบบ Fast firing ในเชิงพาณิชย์ให้ค่า Fill Factor (FF) สูงถึง 0.8 ซึ่งค่า FF มีผลอย่างมากต่อ ค่าประสิทธิภาพของเซลล์ ค่า FF ต่ำบ่งบอกถึงผลกระทบของค่าความต้านทานอนุกรม R_s ในเซลล์มีค่าสูง จากระบบ Fast firing ในห้องปฏิบัติการมีอุณภูมิไม่สูงเพียงพอ ดังนั้นในระบบ Fast firing ที่สร้างขึ้น จำเป็นต้อง Upscale พิกัดของอุณหภูมิห้องโซน 4 ให้สูงกว่า 890°C เพื่อให้รอยเชื่อมสัมผัสระหว่างโลหะ กับ Si ให้มีคุณภาพมากขึ้น จากการศึกษาของ Wang และคณะ (Nanoscale Research Letters (2016) 11, 453) กว่างถึงผลของ FF ที่สูงกว่า 0.8 สามารถส่งผลให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการแปลง พลังงานสูงเกินกว่า 20% ได้ แม้ว่าค่า V_{oc} < 580 mV ก็ตาม ดังนั้นอุณหภูมิของ Fast firing สำหรับ ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นจุดสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์คุณภาพสูง

2. ระบบการพิมพ์ลวดลายโลหะ ซึ่งการผลิตในห้องปฏิบัติการใช้การพิมพ์ลายด้วยมือ ขนาด Mesh ขนาดใหญ่กว่าที่ใช้ในอุสาหกรรม ดังนั้นขนาดของเส้นขั้วกริดไฟฟ้าด้านบนมีค่าใหญ่กว่า และความหนาของ ขั้วไฟฟ้าที่ได้หนากว่า ส่งผลให้เกิดค่าความต้านทานภายในแบบอนุกรมสูงกว่า

4.5 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และความคุ้มค่า

ต้นทุนการผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์มาจากส่วนหลัก ๆ ที่ประกอบด้วยค่าเครื่องจักร ค่าบำรุง เครื่องจักร ค่าเสื่อมราคา ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ค่า จัดเก็บและการบรรจุ แสดงราย<mark>ละเอีย</mark>ดในตารางที่ 4.5

ในงานศึกษานี้ได้นำข้อมูล<mark>ต้นทุนการผลิตจากบริษัทโซ</mark>ลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) มาเป็นข้อมูล เปรียบเทียบกับการผลิตเซลล์ LBSF ด้วยวิธีต้นทุนต่ำจากการประทับลาย เพื่อควาดการณ์ค่าปริมาณ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อหนึ่งแผ่นเซลล์มาตรฐาน (W/pc.) ซึ่งเซลล์ 1 แผ่นมีขนาด 243.36 cm² การ วิเคราะห์ต้นทุนได้พิจารณาความสามารถในการผลิตเซลล์ของเครื่องจักรได้ทั้งหมด 10 ล้านเซลล์

รูปที่ 4.20 และ 4.21 แสดงสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าแผ่นเซลล์ ผลึกซิลิคอนมีสัดส่วนสูงสุดประมาณ 57% ของต้นทุนการผลิตเซลล์ทั้งหมด หรือพิจารณาเป็นราคา ประมาณ 10.04 cent/Watt และมูลค่าการซ่อมบำรุงเครื่องจักรมีสัดส่วนน้อยที่สุดประมาณ 3% หรือ ประมาณ 0.53 cent/Watt ข้อมูลทั้งหมดได้จากบริษัทโซลาร์ตรอนจำกัด (มหาชน)

ชนิดของต้นทุน	ลักษณะ	วัสดุ		
	Wafer	c-Si wafers		
	Chemical	HF, HNO3, Texture Additive,		
		HCl and KOH		
	Gas	Liquid Nitrogen, SiH ₄ , POCl ₃ ,		
		O_2 and NH_3		
1. Direct Cost (Raw material)		Silver Paste for Front Contact		
	Metal Paste	Silver Paste for Rear Contact		
		Aluminium Paste for Rear side		
		Screen for Ag front contact		
	Screen and squeegee	Screen for Ag rear contact		
		Screen for Al rear contact		
		Squeegee Rubber		
2. Preventive maintenance COST	Standard machine	ค่าซ่อมบำรุง เช่น สายพาน, มอร์เตอร์,		
(ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร)		หลอดไฟ, สายไฟ, ท่อแก๊ส,ท่อสารเคมี และ		
		ชิ้นส่วนเสื่อมสภาพ อื่นๆ		
3. Depreciation (ค่าเสื่อมสภาพ	Standard machine	ค่าเสื่อมสภาพ = (ราคาต้นทุน-ราคาซาก)/		
เครื่องจักรและอาคารสถานที่)		อายุการใช้งาน		
4.Labor cost, Consumable,	ค่าแรง	ค่าจ้างพนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำ ค่าไฟ		
Electricity & water and Other	และสาธารณูปโภค	ค่าแพคเกจ		

ตารางที่ 4.5 ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์

รูปที่ 4.20 สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของประเภทต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนในเชิงพาณิชย์

Cost of standard solar cell (cents/watt)

ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกโพลีซิลิคอนโครงสร้าง มาตรฐานอุสาหกรรมในประเทศไทย กับการคาดการณ์ต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกโพลีซิลิคอน สำหรับงานวิจัยนี้ที่มีโครงสร้าง LBSF ที่เปิดช่อง Localized p⁺⁺ ด้วยเทคนิคการประทับลาย โดยได้นำ ข้อมูลประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (Power conversion efficiency; PCE) ของเซลล์โครงสร้าง LBSF ที่ใช้เทคนิค Laser doping ได้ให้ค่า PCE ประมาณ 20% [31] จากงานของคณะวิจัย D. Lin

ผลการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตพบว่า กระบวนการเพิ่มขึ้นของโครงสร้างเซลล์แบบ LBSF ส่งผลต่อต้นทุนราคาของ 1 เซลล์ที่มากขึ้นจากราคาประมาณ 26.34 บาท เป็น 27.66 บาท หรือ สูงขึ้น ประมาณ 5.01% อย่างไรก็ตามเซลล์โครงสร้าง LBSF ที่ผลิตด้วยเทคนิคการประทับลายคาดการณ์ว่าเมื่อ ผลิตในขนาดอุตสาหกรรมจะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า 20% ทำให้ราคาต้นทุนต่อวัตต์ลดลงมากกว่า 3.43% จากราคาต้นทุน 17.66 cent/watt ลดลงเป็น 17.06 cent/watt ดังนั้นเซลล์โครงสร้าง LBSF ด้วยวิธี ประทับลายซึ่งสามารถผลิตร่วมกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมได้นั้น มีต้นทุนการผลิตต่อวัตต์ลดลงได้ จึงแสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก ชิลิคอนโครงสร้าง LBSF เข้าสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และด้านทางเศรษฐศาสตร์ได้แสดงถึงความคุ้มค่า ต่อการลงทุน ขณะที่โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ PERC ที่ให้ PCE ประมาณ 21.7% มีต้นทุนของเซลล์ เท่ากับโครงสร้าง LBSF ด้วยวิธี Laser doping ประมาณ 17 cent/Watt แสดงราคาต้นทุนของการผลิต เซลล์โครงสร้างต่าง ๆ ในตลาดโลกในตารางที่ 4.7 ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกโพลีซิลิคอนโครงสร้างมาตรฐาน อุสาหกรรมในประเทศไทย กับการคาดการณ์ต้นทุนการผลิตเซลล์ในงานวิจัย

	Cell (Pcs.) = 10,000,000.00 pcs / 1 year					
COST	• เซลล์ในอุตสาหกรรม %PCE = 18% ให้ 4.52 watt/cell หรือ 45,209,835.00 watt /1 year					
classification	● เซลล์ PERL %F	CE = 20% ให้ 4.91 watt/cell หรือ 49,141,125.00 watt /1 year				
Т	ypes	COST	COST per pcs	COST per Watt	COS⊤ per watt	
		Amount (THB)	(THB/pcs.)	(THB/watt)	(cents/watt)	
1. Direct Cost	(Raw material)					
Wafer		66,000,000.00	6.60	1.34	4.07	
Chemical		4,976,040.74	1.50	0.30	0.92	
Gas		29,382,375.2 <mark>8</mark>	2.94	0.60	1.81	
Metal Paste		34,720,16 <mark>4.66</mark>	3.47	0.71	2.14	
Screen and S	queegee	4,684,68 <mark>3</mark> .44	0.47	0.10	0.29	
Standard Ce	ll Cost Sum #1	149,763,264.13	14.98	3.31	10.04	
Additional ch	nemical for PERL	2,94 <mark>1,45</mark> 7.49	0.29	0.06	0.18	
Additional ga	s for PERL	10,2 <mark>07,8</mark> 34.33	1.02	0.21	0.63	
Flash foam fo	or PERL	23,598.55	0.002	0.0005	0.001	
PERL Cost Sum #1		162,936,154.50	16.29	3.32	10.05	
2. Preventive maintenance COS						
Standard machine		7,832,704.62	0.78	0.16	0.48	
Standard Cell Cost Sum #2		7,837,704.62	0.78	0.16	0.48	
Additional stamp machine		5,000.00	0.001	0.0001	0.0003	
PERL Cost Sum #2		7,837,704.62	0.78	0.16	0.48	
3. Depreciatio	n 🤸					
Standard ma	chine O	49,733,573.99	4.97	1.01	3.07	
Standard Ce	ll Cost Sum #3	49,733,573.99	4.97	1.01	3.07	
Additional st	amp machine	20,000.00	0.0020	0.0004	0.001	
PERL Cost Sum #3		49,753,573.99	4.98	1.01	3.07	
4. Labor cost, Consumable,		56,072,564.13	5.61	1.14	3.46	
Electricity & water and Others						
Total cost for Standard Cell		263,402,105.86	26.34	5.83	17.66	
Total cost for PERL Cell		276,599,997.23	27.66	5.63	17.06	
Total Watt	for standard Cell	= 4.52 Watt/piece	and Total Cos	t = 17.66 cent/Wa	att (PCE = 18%)	
Total Wat	t for PERL Cell =	4.91 Watt/piece a	nd Total Cost =	= 17.06 cent/Watt	: (PCE = 20%)	

*หมายเหตุ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 US = 33 บาท

Solar PV Cell Weekly Spot Price					
ltem	High	Low	Average	AvgChg	AvgChg %
Multi Cell Price Per Watt	0.135	0.090	0.104	- 0	- 0%
Non China Poly Cell Per Watt	0.140	0.090	0.104	- 0	- 0%
Poly PERC Cell Per Watt	0.135	0.105	0.112	- 0	- 0%
Non China Poly PERC Cell Per Watt	0.135	0.115	0.123	- 0	- 0%
Mono PERC Cell Per Watt	0.170	0.145	0.151	- 0	- 0%
Non China Mono PERC Cell Per Watt	0.170	0.145	0.150	- 0	- 0%
High Eff Mono PERC Cell Per Watt	0.170	0.150	0.157	- 0	- 0%
156 mm Multi Solar Cell	0.630	0.400	0.477	- 0	- 0%
156 mm Mono Solar Cell	0.870	0.530	0.610	- 0	- 0%
China Poly Cell Per Watt	Visit	here for mo	re detail Cell	price inform	ation
Non (TW or CN) Poly Cell Per Watt	Visit	here for mo	re detail Cell	price inform	ation
Unit: USD	mc	ore		Last Update	e: 2018-12-19

ตารางที่ 4.7 สรุปต้นทุนการผลิตแผ่นเซลล์ในโครงสร้างต่าง ๆ ของตลาดโลก ข้อมูลจาก http://pvinsights.com/

High Efficiency Mono PERC Cell: The Prices are mainly represented to solar cells for 21.7% efficiency with less than 2% of CT efficiency lost.

4.6 สรุป

ในบทนี้ได้ศึกษาเงื่อนไขการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบโครงสร้าง LBSF ด้วยการใช้เครื่อง Flash foam stamp ในเงื่อนไขลวดลายแบบเส้น และแบบจุดที่ Aperture ratio 5-100% การประทับครั้งแรก ได้ประทับลายของโบรอนซึ่งเป็นแหล่งสารเจือสำหรับการสร้างบริเวณ p⁺⁺ ด้านหลังเซลล์ และขั้นตอนการ ประทับลายของกรดไฮโดรฟลูออริก สำหรับสกัดเปิดช่องให้กับชั้นไดอิเล็กทริกที่บริเวณเดียวกันกับ p⁺⁺ ซึ่ง ขนาดลวดลายดังกล่าวมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมาก โดยเซลล์ที่มี ขนาดลายเส้น 500 µm ที่ Aperture ratio 15% ให้ค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 1.46% เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ ไม่เปิดช่อง ดังนั้นเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ด้วยวิธีประทับลาย สามารถนำไปผลิตในระดับ อุตสาหกรรมได้ เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ขั้นตอนการผลิตเซลล์ไม่ซับซ้อนสอดคล้องกับการผลิตเดิมที่มีอยู่ คาดการณ์ว่าสามารถให้ราคาต้นทุนต่อวัตต์ลดลงมากกว่า 3.43% จากราคาต้นทุน 17.66 cent/watt ของ เซลล์มาตราฐานลดลงเป็น 17.06 cent/watt เมื่อพิจารณาค่า PCE เท่ากับ 20%

บทที่ 5

สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลงานวิจัย

5.1.1 การออกแบบและสร้างเครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์

ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องประทับลายกึ่งอัตโนมัติต้นแบบสำหรับการผลิตเซลล์ แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ที่มีต้นทุนต่ำกว่าเทคนิคที่ใช้เลเซฮร์เพื่อเปิดช่องไดอิเล็กทริก ขั้นตอนของการ ประทับลายไม่มีความซับซ้อน สามารถประทับลวดลายฟิล์ม BSG จากสารละลายโบรอนได้โดยตรง และ เครื่องประทับลายต้นแบบนี้ยังสามารถใช้สกัดฟิล์มไดอิเล็กทริกเป็นบริเวณหรือลวดลายตามต้องการได้ โดยตรง ไม่ซับซ้อนเหมือนกับวิธี Photolithography ซึ่งโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ LBSF ต้องการ ลวดลายในขนาดหลักร้อยไมครอน ดังนั้นวิธีการประทับลายจึงมีความเหมาะสมมาก เครื่องสามารถปรับ ระดับหัวประทับบนชิ้นงานได้หลายระดับ ขึ้นกับขนาดของลวดลาย และสารละลายที่ถ่ายทอดลวดลายลง บนชิ้นงาน ชุดหัวประทับลายสามารถสวมประกอบร่วมกับแผ่น Flash foam และสามารถเปลี่ยนขนาด พื้นที่ใหญ่ได้

5.1.2 การถ่ายทอดลวดลายด้วย Foam stamp

ได้ประสบความสำเร็จการทดสอบสร้างลวดลายด้วยการใช้ Foam stamp และสามารถนำไป ประยุกต์ได้หลายประเภท เช่นประทับลวดลายของสารละลายสารเจือเช่นโบรอน หรือสามารถนำไป ประทับลายเพื่อสกัดฟิล์มไดอิเล็กทริคในบริเวณที่ต้องการได้โดยตรง หรือสามารถประทับสารไวแสงเพื่อ เป็นหน้ากากป้องกันการสกัดผิวขึ้นงานได้โดยตรง ในงานประยุกต์ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง Selective Emitter สามารถผลิตเป็นบริเวณ n⁺⁺ region หรือ p⁺⁺ได้ในเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF วิธีการประทับลายจึงเป็นวิธีทางเลือกต้นทุนต่ำสำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรมได้ ขนาดลวดลายที่ผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 100 μm ลวดลายที่ผลิตได้มีความแม่นยำ มีความคลาดเคลื่อนจากแบบ ไม่เกิน 2.5%

5.1.3 การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนต้นแบบด้วยวิธีการประทับลาย

ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบโครงสร้าง LBSF ด้วยการใช้เครื่อง Flash foam stamp ในเงื่อนไขลวดลายแบบเส้น และแบบจุดที่ Aperture ratio 5-100% การประทับ ครั้งแรกได้ประทับลายของโบรอนซึ่งเป็นแหล่งสารเจือสำหรับการสร้างบริเวณ p⁺⁺ ด้านหลังเซลล์ และ ขั้นตอนการประทับลายของกรดไฮโดรฟลูออริก สำหรับสกัดเปิดช่องให้กับชั้นไดอิเล็กทริกที่บริเวณเดียวกัน กับ p⁺⁺ ซึ่งขนาดลวดลายดังกล่าวมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมาก โดย เซลล์ที่มีขนาดลายเส้น 500 µm ที่ Aperture ratio 15% ให้ค่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 1.46% เมื่อเทียบกับ เซลล์ที่ไม่เปิดช่อง ดังนั้นเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ด้วยวิธีประทับลาย สามารถนำไปผลิตในระดับ อุตสาหกรรมได้ เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ขั้นตอนการผลิตเซลล์ไม่ซับซ้อนสอดคล้องกับการผลิตเดิมที่มีอยู่

5.1.4 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนโครงสร้าง LBSF ต้นแบบด้วยวิธีการ ประทับลาย

กระบวนการเพิ่มขึ้นของโครงสร้างเซลล์แบบ LBSF ด้วยวิธีการประทับลายส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น ของต้นทุนจากราคาประมาณ 26.34 บาท/cell เป็น 27.66 บาท/cell หรือ สูงขึ้นประมาณ 5.01% อย่างไร ก็ตามคาดการณ์ว่าเมื่อผลิตในมาตราฐานอุตสาหกรรมจะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า 20% ทำให้ราคาต้นทุน ต่อวัตต์ลดลงมากกว่า 3.43% โดยมีราคาต้นทุนเซลล์ประสิทธิภาพสูงทั่วไปอยู่ที่ 17.66 cent/watt จะ ลดลงเป็น 17.06 cent/watt ดังนั้นเซลล์โครงสร้าง LBSF ด้วยวิธีประทับลายซึ่งสามารถผลิตร่วมกับ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมได้นั้นสามารถให้ต้นทุนการผลิตต่อวัตต์ลดลงได้ จึงแสดงให้เห็นว่า ผลการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนโครงสร้าง LBSF เข้าสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และด้านทางเศรษฐศาส</mark>ตร์ได้แสดงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการทดสอบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF พบว่าประสิทธิภาพารแปลงพลังงานของ เซลล์สูงกว่าเซลล์ที่มีชั้น SiN_x เคลือบด้านหลังทั่วแผ่น ซึ่งเป็นผลมากจากการเพิ่มขึ้นของ V_{oc} จากชั้น สนามไฟฟ้าด้านหลัง การเพิ่มขึ้นของ J_{SC} จากการลดผลกระทบของค่าอัตราการรวมตัวใหม่ของพาหะ อย่างไรก็ตามค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสุทธิของเซลล์ยังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าฟิลแฟค เตอร์ ซึ่งค่า FF ของกลุ่มเซลล์ทดสอบยังมีค่าต่ำกว่า 0.7 เนื่องจากคุณภาพของขั้วไฟฟ้าจาก Fast firing ที่ 890°C ยังเป็นเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าค่า V_{oc} และ J_{SC} จะมีค่าสูงก็ตาม ดังนั้นในงานวิจัยนี้สามารถ ศึกษาต่อยอดและพัฒนาค่า FF ให้สูงกว่า 0.7 ได้ด้วยการใช้อุณหภูมิ Firing ที่ขั้วไฟฟ้าของเซลล์ ให้มีค่าสูง กว่า 890°C ซึ่งจะส่งผลให้เซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ให้ประสิทธิภาพสูงกว่า 20% ได้

บรรณานุกรม

[1] J. Mandelkorn, and J.H. Lamneck, "A New Electric Field in Silicon Solar Cells", *J. Appl. Phys.*, **44**, (1973) pp.4785

[2] R. Hazel, and K. Jaeger, "Low Temperature Surface Passivation of Silicon Solar Cells",J. El. Chem. Soc. 136, (1989) pp. 518

[3] A.W. Blakers, A.Wang, A.M. Miline, J. Zhao, and M.A. Green, "22.8% efficient Silicon Solar Cells", *Appl. Phys. Let.* **55**, (1989) pp.1363

[4] J. Zhao, A. Wang, and M.A. Green, "24% Efficient PERL Structure Silicon Solar Cells", 21st IEEE Photovoltaic Special Conference, (1990) pp.333

[5] A. Metz, and R. Hezel, "High-quality passivated rear contact structure for silicon solar cells based on simple mechanical abrasion", 28th IEEE Photovoltaic Special Conference, (2000) pp.172

[6] J-H Guo, BS. Tjahjono, JE. Cotter, "19.2% Efficiency N-Type Laser Grooved Silicon Solar Cells", 31st *IEEE Photovoltaic Special Conference*, (2005) pp.983

[7] D. De Ceuster, P. Cousins, D. Rose, D. Vicente, P. Tipones, W. Mulligan, "Low Cost, High Volume Production of >22% Efficiency Silicon Solar Cells", *Proc.*22nd *EU-PVSEC*, (2007) pp.816

[8] P. Engelhart, N-P Harder, R. Grischke, A. Merkle, R. Meyer, R. Brendel, "Laser Structuring for Back Junction Silicon Solar Cells" *Progress. in Photovoltaic: Research and Application* ,15, (2006) pp.237

[9] D. Huljic, T. Zerres, A. Mohr, Kv. Maydell, K. Petter, JE Müller, H. Feist, N-P Harder, P. Engelhart, T. Brendemühl, R. Grischke, R Meyer, R. Brendel, F. Granek, A. Grohe, M. Hermle, O. Schultz, SW. Glunz, "Development of a 21% Back-Contact Monocrystalline Silicon Solar Cell for Large Scale Production" *21st EU-PVSEC* (2006)

[10] F. Granek, M. Hermle, D. M. Huljíc, O. S. Wittmann, and S. w. Glunz, "Enhanced Lateral Current Transport via the Front N⁺Diffused Layer of N-Type High-Efficiency Back-Junction Back-Contact Silicon Solar Cells" *Proc. in Photovoltaic: Research and Application*,**17**, (2006) pp.47

[11] H. Somberg, "Ink jet printing for metallization on very thin solar cells" 21st IEEE Photovoltaic Special Conference, (1990) pp.666 [12] F.C. Krebs, Fabrication and processing of polymer solar cells: A review of printing and coating techniques, *Solar Energy Materials and Solar Cells*, **93** (2009), pp. 394

[13] A. J. Lennon, R. Y. Utama, M.A.T. Lenio, A.W.Y. Ho-Baillie, N. B. Kuepper and S. R. Wenham, Forming openings to semiconductor layers of silicon solar cells by inkjet printing, *Solar Energy Materials and Solar Cells*, **92**, (2008) pp. 1140.

[14] N.-P Harder, A. B. Sproul, T. Brammer, and A. G. Aberle, Effects of Sheet Resistance and Contact Shading on the Characterization of Solar Cells by Open-Circuit Voltage Measurement, J. Appl. Phys., **94**, (2003) 2473.

[15] S. Y Hwang, et .al., "Fabrication of roll imprint stamp for continuous UV roll imprinting process", Microelectronic Engineering Volume 86, Issues 4–6, (2009) 642–645

[16] K. S Han, et .al., "Enhanced transmittance of glass plates for solar cells using nanoimprint lithography", Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 94, Issue 3, (2510) 583– 587

[17] S. Landis, et al., Silicon solar cells efficiency improvement with Nano Imprint Lithography technology, Microelectronic Engineering, Volume 111, (2013) 224–228

[18] M.A. Green (2001), Crystalline silicon solar cells, London: Imperial College Press.

[19] S. Gall, et.al., Boron laser doping through high quality Al2O3 passivation layer for localized B-BSF PERL solar cells, Energy Procedia, vol. 38, (2013) pp. 270-277

[20] Z. Wang, Han, et. al., Advanced PERC and PERL production cells with 20.3% record efficiency for standard commercial p-type silicon wafers, Prog. Photovolt: Res. Appl, vol. 20, (2012) pp. 260–268.

[21] Y. Eisenberg, et. al., Effective Surface Recombination of p+ Layers Doped Using Ion Implantation or Surface Deposited B Sources, Energy Procedia, vol. 92, (2016) pp. 16-23.

[22] H. Yong, et.al., A facile and low-cost micro fabrication material: flash foam, Scientific Reports, (2015) vol. 5:13522

[23] G. L. Vick, et.al., Solid Solubility and Diffusion Coefficients of Boron in Silicon, J. Electroehem. Soc.: SOLID STATE SCIENCE, vol. 116, (1969) pp.1142-1144.

[24] U. Jager, et.al., Local boron doping for p-type PERL silicon solar cells fabricated by laser processing of doped silicon nanoparticle paste, paper presented in the 29th European PV Solar Energy Conference and Exhibition, Amsterdam, The Netherlands.

[25] A. Kränzl, et.al., Bifacial solar cells on multicrystalline silicon with boron BSF and open rear contact, paper presented in the 4th IEEE World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, (2006) Hawaii, United States of America. [26] D.P. Armel, et.al., Sol-gel deposited phosphorus and boron doped thin silica films for diffused n⁺p and n⁺pp⁺ structures, Physica Status Solidi, vol. 11, Issue 11-12, (2014) pp. 1654–1656.

[27] D.S. Kim, et.al., Silicon solar cells with boron back surface field formed by using boric acid, paper presented in the 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference, (2007). Milan, Italy.

[28] T. Katsu, (2002). Space solar cell, Google Patents.

[29] G. Singh, et.al., Fabrication of c-Si solar cells using boric acid as a spin-on dopant for back surface field, RSC Advances, vol. 4, (2013) pp. 4225–4229.

[30] F.M. Smits, Measurement of sheet resistivities with the four-point probe, Bell System Technical Journal, vol. 37, (1958) pp. 711-718.

[31] D. Lin, M. Abbott, P. H. Lu, B. Xiao, B. Hallam, B. Tjahjono, S. Wenham, Incorporation of deep laser doping to form the rear localized back surface field in high efficiency solar cells, Solar Energy Materials & Solar Cells 130 (2014) pp. 83–90.

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4422 4582 0856613088 โทรสาร 0 4422 4601

thipwan@g.sut.ac.th

ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์

Assistant Professor Dr. Thipwan Fangsuwannarak

ประวัติการศึก	ษา ระดับปริญญาเอก
	2551 Ph.D. (Photovoltaic Engineering) Centre of Excellence for Advanced
	Silicon Photovoltaics and Photonics, University of New South Wales,
	Australia
	ระดบปรญญาเท
	2540 วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต (Electrical Engineering, Semiconductor
	Devices Research Laboratory, SDRL) จุฬาลงกรณมหาวทยาลย กรุงเทพๆ
	ระดบบรญญาตร
	2556 มหามารมหาโสตรบในของในยองในยอนตบ 2 (B.Eng (2 " Honor in Electronic
	Engineening) มหาวิทยาลยวงเซงาลตกุล จ. นครราชสมา
ประวัติการทำง	ทน
2540-ปัจจบัน	อาจารย์ประจำ และนักวิจัย วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สรนารี จ.นครราชสีมา
2557-ปัจจุบัน	ผู้ทรงค <mark>ุณวุฒิ</mark> ให้ข้อคิดเห็นและประเมินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในก [่] ารทำงานวิจัยของ
Y	อาจารย์รุ่นใหม่ และทบพัฒนานักวิจัย (รุ่นกลาง) ของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทนสนับสนุน
	อาราวิอัย (สถา)
2555	ทปรึกษา R&D group, Innovative Harvesting Energy, China
2554	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ให้แก่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล HDD
	สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2552-2554	วิทยากรผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมการผลิตและวิเคราะห์ฟิล์มบาง อุสาหกรรมฮาร์ดิสไดฟ์ ให้แก่
	บริษัทซีเกต บริษัทเวสเทินท์ดิจิตอล บริษัทฮิตาชิฮาร์ดิสไดฟ์
2553	ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ และจัดบรรยาย อบรมภาคสนาม ให้แก่ชุมชน
	้อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา
2548-2550	นักวิจัยในกลุ่มโครงการ Global Climate and Energy Project (GCEP) แหล่งทุนจาก
	Stanford University, USA
2539-2540	นักวิจัยห้องปฏิบัติวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Devices Research
	Laboratory, SDRL)) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2536-2537	อาจารย์ สาขาวิศวกรรบไฟฟ้า บหาวิทยาลัยศรีบครีบทราโรตเ บางเขบ กรงเทพฯ
2000 2001	

สาขาวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ

- การผลิตวัสดุผลึกนาโนสารกึ่งตัวนำชนิดใหม่จาก nc-Si ink และ ZnO:Bi film การวิเคราะห์วัสดุสาร กึ่งตัวนำขั้นสูง และวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงาน
- การผลิตเซลล์อาทิตย์และพัฒนาประสิทธิภาพด้วยเทคนิคต้นทุนต่ำ
- ออกแบบระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ในแบบระบบอิสระและระบบที่เชื่อมต่อระบบสายส่ง
- ออกแบบระบบไฮบริดพลังงานทดแทนจากงระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบเก็บเกี่ยว พลังงานด้วยเพียโซอิเล็กทริก

ผลงานและรางวัล

- ยื่นจดสิทธิบัตร Patent (25 ก.ค. 2558) การประดิษฐ์ "แผ่นพื้นอัจฉริยะสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า จากแรงเฉื่อยเชิงกล" เลขที่คำขอ 1601002468
- ยื่นจดสิทธิบัตร Patent (16 ธ.ค. 2558) การประดิษฐ์ "เซลล์นำไฟฟ้าพลังแสงด้วยผลึกนาโนทรงกลม ซิงค์ ออกไซด์เจือสารบิสมัท และวิธีการผลิต" เลขที่คำขอ 1501007762
- ลิขสิทธิ์ ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ "โปรแกรมที่กำหนดให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ เป็นตัวควบคุมกระแสไฟฟ้ากริดเอซีของวงจรอินเวอร์เตอร์เต็มบริดจ์เฟสเดียวที่เชื่อมต่อกริด" เลขที่327427 (2558)
- อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (3 ก.พ.2555) "การใช้วัสดุเทฟลอนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์โดยไม่ใช้ สารละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์" เลขที่อนุสิทธิบัตร 6976
- บทความยอดเยี่ยม Energy Materials paper award for 7th Conference on Energy Network of Thailand, 2011 "การสร้างชั้นพาสซิเวชันด้านหลังสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนด้วย วิธีการทะลุของอะลูมิเนียม และการแลกเปลี่ยนเฟสระหว่างชั้น"
- 6. Research Group Scholarship: Global Climate and Energy Project (GCEP) 2005-2007, Stanford University, USA
- 7. Ph.D. Scholarship สำนักงานแผนนโยบายพลังงานแห่งชาติ ประเทศไทย ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ Third-generation of Silicon Solar cells ศึกษาที่ Centre of Excellence for Advanced Silicon Photovoltaics and Photonics, UNSW, Australia

ภาระงานสอนและที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์

สอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในรายวิชาดังนี้

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ เซลล์แสงอาทิตย์ประยุกต์ เซลล์ แสงอาทิตย์และระบบ เทคโนโลยีวงจรรวม วงจรรวมดิจิตอล และวัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า

ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์

ฟิล์มบาง ZnO:Bi สำหรับป้องกันการสะท้อนแสงของเซลล์แสงอาทิตย์

- หมึกฟอสฟอรัสสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงแบบ Selective Emitter Cell
- เครื่องฉีดสารสำหรับสร้างชั้นพาสซิเวชันให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนด้วยวิธีต้นทุนต่ำ

สังเคราะห์ฟิล์มบางผลึกนาโนซิลิคอนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ Third Generation

การบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

```
งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
```

1. งานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์เจือบิสมัทด้วยการเติมสารลดแรงตึง ผิวเพื่อประยุกต์ใช้งานทางเซลล์แสงอาทิตย์และออปโตอิเล็กทรอนิกส์ สถาณภาพ ผู้ร่วมวิจัย (40%) แหล่งทน วช. 2558 เสร็จสมบูรณ์ ้งานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงค่าความนำไฟฟ้าและช่องว่างอิเล็กทรอนิกส์ทางแสงของผลึกนาโน 2. ซิลิคอนควอนตัมดอทสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ สถานภาพ หัวหน้าโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ปี แหล่งทุน วช. 2556 เสร็จสมบรูณ์ ้งานวิจัยเรื่อง การสร้างผิวซิลิค<mark>อน</mark>ขรุขระรูปทรงพีระมิดสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการใช้ หน้ากากกริดในสารละลายเคมีที่ไม่ใช้ไ<mark>อโซ</mark>โพรพิลแอลกอฮอร์ สถานภาพ หัวหน้าโครงการวิจัยร<mark>ะยะเวลา</mark> 1 ปี แหล่งทุน วช. 2555 เสร็จสมบ<mark>รู</mark>ณ์ ้งานวิจัยเรื่อง เทคนิคต้นทุน<mark>ต่ำ</mark>ด้วยกา<mark>ร</mark>ฉีดสารละลายเพื่อสร้างชั้นรอยต่อพาสซิเวชันคุณภาพสูงที่ 4. ด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ช<mark>นิดซิ</mark>ลิคอน สถานภาพ หัวหน้าโครงกา<mark>รวิจ</mark>ัยระยะเวล<mark>า 2 ปี</mark> แหล่งทุน วช. 2554-<mark>255</mark>5 เสร็จสมบรูณ์ ้งานวิจัยเรื่อง การเ<mark>ตรียม</mark>ผลึกนาโนซิลิคอนแล<mark>ะกา</mark>รประยุกต์ใช้งานกับเซลล์แสงอาทิตย์ 2. สถานภาพ หัวหน้าโ<mark>ค</mark>รงการวิจัยระยะเวลา 2 ปี แหล่งทุน วช. 2553-2554 เสร็จสมบรูณ์ งานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพของผิวพาซิเวชันด้านหลัง ต้นทุนต่ำ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ สถานภาพ ห<mark>ัวหน</mark>้าโค<mark>รงการวิจัยระยะ</mark>เวลา 1 ปี แหล่งทุน สกว. 2552 เสร็จสมบรูณ์ ้งานวิจัยเรื่อง <mark>การลดการสะท้อนแสงที่ผิวหน้าเซลล์ด้วย</mark> ANISOTROPIC TEXTURE ETCHING เพื่อ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการแ<mark>ปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์</mark>ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน สถานภาพ หัวหน้าโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ปี อโมโลยีส์ วช. 2552 เสร็จสมบรูณ์ แหล่งทุน งานวิจัยเรื่อง Global Climate and Energy Project (GCEP) 2005-2007, Stanford University, 5. USA สถานภาพ ผู้ร่วมวิจัย Stanford University, USA แหล่งทุน ้งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเครื่องยนต์ฟลูอิดไดน์และการประยุกต์ใช้งาน : ออกแบบทรานสดิวเซอร์ใน 6. ภาค tuning line สถานภาพ หัวหน้าโครงการ ใช้ระยะเวลา 1 ปี (2545) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสร็จสมบรูณ์ แหล่งทุน งานวิจัยเรื่อง การสร้างชั้นรอยต่อพาสซิเวชันคุณภาพสูงของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคต้นทุนต่ำ 7. จากการประทับลาย สถานภาพ หัวหน้าโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ปี แหล่งทุน วช. 2558

ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์

Assist. Prof. Dr. Thipwan Fangsuwannarak

 งานวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์หมึกผสมผลึกนาโนซิลิคอนสำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบ ใหม่และต้นทุนต่ำ สถานภาพ หัวหน้าโครงการวิจัยระยะเวลา 2 ปี

แหล่งทุน วช. 2557

งานวิจัยที่กำลังทำ

 งานวิจัยเรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหมึกซิลิคอนควอนตัมดอทจากการใช้แผ่นเซลล์ที่เสื่อมสภาพ เสียหายมาผลิตใหม่

สถานภาพ หัวหน้าโครงการวิจัย ระยะเวลา 1 ปี

แหล่งทุน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน งบประมาณปี 2561

 งานวิจัยเรื่อง วัสดุอัจฉริยะ (smart materials) สำหรับพลังงานทดแทนในอนาคต สถานภาพ ผู้ร่วมวิจัย ระยะเวลา 1 ปี แหล่งทุน วช. 2561

ผลงานเผยแพร่

- 1. Supanut Laohawiroj, Apirak Mangkornkaew, Atthaphon Maneedaeng, Thipwan Fangsuwannarak, "Silicon composite ink for advanced photovoltaic generation prepared by low-cost technique" Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology, Volume 13 No.2 (2018)
- กมลชนก เมฆหมอก วรากร ลิ้มศิริ และ ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ "การสร้างชั้น Local Back Surface Field (LBSF) ที่ด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนโดยวิธีการประทับลายด้วย Flash foam" การประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 13-15 มิถุนายน 2561 จ.ระยอง หน้า 791-794
- พีรวุฒิ รัตนวิชัย ศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ รุ่งเรือง พัฒนากุล และ ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ "การศึกษาสมบัติ ทางจุลโครงสร้างและทางแสงของฟิล์มบางผลึกนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยบิสมัทสาหรับการประยุกต์ใน เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์" การประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 13-15 มิถุนายน 2561 จ.ระยอง หน้า 879-885
- 4. ศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ พีรวุฒิ รัตนวิชัย รุ่งเรือง พัฒนากุล และ ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ " การสังเคราะห์ฟิล์มบางซิลิคอนดอทในเมตริกซ์ของซิงค์ออกไซด์โด๊ปบิสมัทจากหมึกคอมโพสิทซิลิคอน และ คุณสมบัติทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดวัสดุขั้นสูง " การประชุม วิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 13-15 มิถุนายน 2561 จ.ระยอง หน้า 899-905
- กมลชนก เมฆหมอก ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ และ ณัฐพล ช่วงสุวนิช "ผลของการเคลือบชั้นป้องกันการ สะท้อนแสงแบบ Gradient-Index ที่มีผลต่อสมบัติทางแสงและไฟฟ้าของการผลิตแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์สี ดำ" การประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 จ. เชียงใหม่ หน้า 458-463
- 6. S. Chanrawangyot, S.T. Rattanachan, A. Watcharenwong, **T. Fangsuwannarak**, Antibacterial activity of ZnO nanoparticles coated on ceramic tiles prepared by sol-gel method, Journal

of Metals, Materials and Minerals, Volume 27, Issue 2, p. 1-5 (2017)

- 7. A. Mangkornkaew and **T. Fangsuwannarak**, Characterization of patterns of Localized Doping Using Stamping technique for Selective n-Emitter Solar Cell Structure, Materials Science and Engineering 241, 012042 (2017)
- 8. Karoon Fangsuwannarak, Ponrawee Wanriko, **Thipwan Fangsuwannarak**, "Effect of Biopolymer Additive on the Fuel Properties of Palm Biodiesel and on Engine Performance Analysis and Exhaust Emission" Energy Procedia, Volume 100, p. 227-236 (2016)
- อภิรักษ์ มังกรแก้ว ชิตพงษ์ เกตุถนอม ธีธัช เลาหวิโรจน์ และ ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ "การสร้างชั้น อิมิตเตอร์และชั้นไดอิเล็กตริกสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนด้วยวิธีการพิมพ์ลาย" การ ประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย 18-20 มิถุนายน 2559 จ. พิษณุโลก หน้า 458-463
- W. Kempet, B. Marungsri, R. Yimnirun, W. Klysubun, T. Fangsuwannarak, S.T. Rattanachan, N. Pisitpipathsin, M. Promsawat, and S. Pojprapa, "Polarization Switching of PZT under Electrical Field via in-situ Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy" Ferroelectrics, 492: p.35–42 (2016)
- อภิรักษ์ มังกรแก้ว และทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ "การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซีเลคทีฟอิมิตเตอร์ด้วย เทคนิคพิมพ์ลาย" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON38) 18-20 พฤศจิกายน 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา
- 12. **T. Fangsuwannarak** "IPA Free Texturization Process for Monocrystalline Silicon Solar Cells by PTFE Mask", The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2015, Kobe Japan, Proceeding p.363-369, 11-14 June (2015)
- T. Fangsuwannarak, A. Mankkornkaew, N. Phiwpha and S. Sopitpan, "Preparation of Different Phosphorus Concentration for N⁺ Selective Emitter Solar cell by Spin on doping", Grand Renewable Energy 2014, Tokyo Big Sight, Tokyo Japan, Proceeding P-PV-3-2, 27 July - 1 August (2014)
- S. T. Rattanachan, J. Kaewphoka and T. Fangsuwannarak, "Annealing Atmosphere of Bismuth Doped Zinc Oxide Thin Films Prepared by CTAB-Assisted Sol-gel Method", Grand Renewable Energy 2014, Tokyo Big Sight, Tokyo Japan, Proceeding P-PV-3-2, 27 July - 1 August (2014)
- 15. J. Kaewphoka, T. Fangsuwannarak and S.T. Rattanachan, "Synthesis of surfactant-assisted nanostructured Bi doped Zinc oxide for photo-sensing application", Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2014 11th International Conference ID paper 1396, 15-17 May (2014)
- 16. N. Phiwpha, **T. Fangsuwannarak** and S. Sopitpan, "Locally contacted rear surface passivated solar cells by inkjet printing", Proc. of SPIE Vol. 9234 92341B-1 (2014)
- 17. N. Phiwpha and **T. Fangsuwannarak**, "Surface Passivation of Point-Contacted Solar Cells by Inkjet Printing" Integrated Ferroelectrics, 149: pp.102-106, (2013)
- S.T. Rattanachan, P. Krongarrom and T. Fangsuwannarak, "Influence of annealing temperature on characteristics of bismuth doped zinc oxide films" American Journal of Applied Sciences Volume 10, Issue 11, 1 October 2013, Pages 1427-1438 (2013)

- T. Fangsuwannarak and K. Kunchana, "Optical Properties of Nano-crystalline Silicon Films Prepared by Using Sol-Gel Spin Coating Process" The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, No. 43: pp.106-110 (2013)
- 20. T. Fangsuwannarak, K. Amonsurintawong and S. Sopitpan, "Aluminum-induced crystallization of p⁺silicon pinholes for the formation of rear passivation contact in solar cell" Key Engineering Materials Vol. 547 (2013) pp. 31-40 (2013) Trans Tech Publications, Switzerland doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.547.31
- 21. **T. Fangsuwannarak**, K. Khunchana and S.T. Rattanachan "Optical Band Gaps and Electrical Conductance of Si nanocrystals in SiO2 Matrix for Optoelectronic Applications" Key Engineering Materials Vol. 545 (2013) pp 134-140 (2013) Trans Tech Publications, Switzerland doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.545.134
- 22. **T. Fangsuwannarak**, P. Krongarrom, J. kaewphoka and S. T. Rattanachan, "Bismuth doped ZnO films as anti-reflection coatings for solar cells" Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 978-1-4799-0545-4/13 ©2013 IEEE
- 23. K. Kunchana and **T. Fangsuwannarak**, "Thin Film preparation of silicon nanocrystals embedded in silicon oxide by sol-gel method" Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 978-1-4673-2025-2/12/ ©2012 IEEE
- 24. Phanuwat Krongarrom, Sirirat T Rattanachan, Thipwan Fangsuwannarak, "ZnO Doped with Bismuth in Case of In-Phase Behavior for Solar Cell Application" Engineering Journal, Vol 16, No 3 p. 59-70 (2012)
- 25. **T. Fangsuwannarak**, P. Krongarrom, and S. T. Rattanachan, "Synthesis and characterizations of bismuth doped zinc oxide via sol-gel technique for solar cells applications" 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg, Germany, 5-9 Sep. (2011)
- 26. P. Krongarrom, S.T. Rattanachan and T. Fangsuwannarak, "Structural and optical characterizations of n-type doped ZnO by sol-gel method for photovoltaic", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2011 8th International Conference on, On page(s): 50 53, Volume: Issue: , 17-19 May (2011)
- 27. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ กิตติศักดิ์ อมรสุรินทวงศ์ และ สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ "การสร้างชั้นพาสซิเวชัน ด้านหลังสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนด้วยวิธีการทะลุของอะลูมิเนียม และการแลกเปลี่ยนเฟส ระหว่างชั้นอะลูมิเนียมกับชั้นอะมอร์ฟัสซิลิคอน" การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 จ.ภูเก็ต 5 - 7 พฤษภาคม 2554 CEN12-562 (บทความยอดเยี่ยมประเภทวัสดุพลังงาน)
- กิตติศักดิ์ อมรสุรินทวงศ์ และ ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ "ผลของการสะท้อนแสงของผิวเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดซิลิคอนที่มีลวดลายพีระมิด" การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, 5 -7 พฤษภาคม 2553 ENETT6-1193
- 29. **T. Fangsuwannarak** and K. Amonsurintawong, "Texturisation of monocrystalline Si wafer by wet chemical etchants without surfactant additive through PTFE masks", 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition and 5th World Photovoltaics

Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Valencia, Spain, 6-10 Sep. (2010)

- 30. T. Fangsuwannarak and G. Scardera, "Effect of Annealing Temperature on Dark Current Density of Silicon nanocrystals embedded in a Nitride Matrix for Photovoltaic Application," Proc. the 5th International Conference in Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology, On page(s): 797 - 800, Volume: Issue: , 14-17 May (2008)
- 31. T. Fangsuwannarak, E.C. Cho, G. Conibeer, Y. Huang, T. Trupke and M.A. Green, "Analysis of The Effect of Silicon Quantum Dot Density on The Photoluminescence Spectra of Silicon Dot/Silicon Dioxide Superlattices," Proc. 21th European Photovoltaic Solar Energy Conf. Dresden, Germany, (2006)
- 32. **T. Fangsuwannarak**, E. Pink, Y. Huang, G. Scardera, G. Conibeer, M. A. Green, "Effects of Silicon Nanocrystallite Density on The Raman-Scattering Spectra of Silicon Quantum Dot Superlattices," *Proc. SPIE* **6415-07** (2006)
- G. Conibeer, M. A. Green, R. Corkish, Y. Cho, E-C. Cho, C-W Jiang, T. Fangsuwannarak, E. Pink, Y. Huang, T. Puzzer, "Silicon Nanostructures for Third Generation Photovoltaic Solar Cells," *Thin Solid Film*, 511-512, 654 (2006).
- 34. M. A. Green, E-C. Cho, Y. Cho, Y. Huang, E. Pink, T. Trupke, A. Lin, T. Fangsuwannarak, T. Puzzer, G. Conibeer, and R. Corkish, "All-Silicon Tandem Cells Based on "Artificial" Semiconductor Synthesised Using Silicon Quantum Dots in Dielectric Matrix," The 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Dresden (2006)
- 35. Scardera, T. Puzzer, D. McGrouther, E. Pink, **T. Fangsuwannarak**, G. Conibeer, and M. A. Green, "Investigating Large Area Fabrication if Silicon Quantum dots in a Nitride Matrix for Photovoltaic Applications," *IEEE World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Hawaii*, **122** (2006)
- T. Fangsuwannarak, E. Pink, Y. Huang, Y. H. Cho, G. Conibeer, T. Puzzer, and M. A. Green, "Conductivity of Self-Organized Silicon Quantum Dots Embedded in Silicon Dioxide," *Proc. SPIE* 6037, 60370T (2005)
- 37. M. A. Green, E-C. Cho, Y. Cho, Y. Huang, E. Pink, T. Trupke, A. Lin, T. Fangsuwannarak, T. Puzzer, G. Conibeer, and R. Corkish, "Artificial Semiconductor Synthesised Using Si Quantum Dots in a Dielectric Matrix," *The 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Barcelona* (2005)
- 38. D. Kruangam, **T. Sujaridchai**, K. Chirakawikul, B. Ratwises and S. Panyakeow, "Novel amorphous silicon alloy optoelectronic integrated circuits," Journal of Non-Crystalline Solids 227-330, 1146-1150 (1998)
- 39. K. Chirakawikul, **T. Sujaridchai**, B. Ratwises, D. Kruangam, S. Panyakeow, W. Boonkosum, T. Sugino and J. Shirafuji, "Preparation of p-type polycrystalline diamond films and their applications to hole injection layers in amorphous SiC:H thin film light emitting diodes," Journal of Non-Crystalline Solids, 227-230, 1156-1159 (1998)
- 40. W. Boonkosum, D. Kruangam, B. Ratwises, T. Sujaridchai, S. Panyakeow, S. Fujikake and H.

Sakai, "Amorphous SiO:H thin film visible light emitting diode," Journal of Non-Crystalline Solids, **198-200**,1226-1229 (1998)

- 41. D. Kruangam, B. Ratwiset, **T. Sujaridchai**, S. Panyakeow, and W. Boonkosum, "Novel Application of Amorphous Silicon Flexible Solar Cells As Battery Charger for Personal Mobile Telephone," Technical Digest of the International PVSEC-9, Japan (1996)
- 42. D. Kruangam, **T. Sujaridchai**, K. Chirakawikul, B. Ratwiset and S. Panyakeow, "Application of Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition to the Fabrication of Si Alloy Optoelectronic Devices," Proceeding of 8th ASIAN Conference on Electrical Discharge ACED, Siam Inter-Continental, Bangkok (1996)
- 43. D. Kruangam, **T. Sujaridchai**, K. Chirakawikul, B. Ratwiset and S. Panyakeow, "Basic Properties of Amorphous Silicon Alloys for Optoelectronic IC Applications," Proceeding of Regional Symposium on Material Science, Fundamental and Applications on Semiconductor and Superconductors, Philippines (1996)
- 44. W. Boonkosum, D. Kruangam, B. Ratwiset, T. Sujaridchai and S. Panyakeow, "Visible Amorphous SiO:H Thin Film Light Emitting Diod," International Conference Amorphous Semiconductors Science&Technology (ICAS) (1995)
- 45. D. Kruangam, W. Boonkosum, B. Ratwiset, T. Sujaridchai and S. Panyakeow, "Fabrication of Amorphous Silicon Alloy Optical Devices for New Types of Thin Film Optoelectronic Integrated Circuits," Australia Microelectronic Conference (MICRO), Adelaide, Australia (1995)
- 46. W. Boonkosum, **T. Sujaridchai**, D. Kruangam, B. Ratwiset and S. Panyakeow, "Novel Matrix and Multi-Layer Amorphous Thin Film LED Flat Panel Display," Spring Meeting of Materials Research Society (MRS), Symposium V-Flat Panel Display San Francisco, USA, (1995)

